

Короткие единичные проверяющие тесты для контактных схем при обрывах и замыканиях контактов

Попков К.А.

Рассматривается задача реализации булевых функций избыточными двухполюсными контактными схемами, допускающими короткие единичные проверяющие тесты относительно обрывов и замыканий контактов. Описаны все функции, для которых минимальная длина указанного теста равна 0, 1, 2 и 3. Доказано, что для почти всех булевых функций от n переменных эта длина равна 4.

Ключевые слова: контактная схема, булева функция, обрыв контакта, замыкание контакта, единичный проверяющий тест.

1. Введение

В работе рассматривается задача синтеза легкотестируемых двухполюсных контактных схем [1], реализующих заданные булевы функции. (Слово «двухполюсная» в дальнейшем будем опускать.) Логический подход к тестированию контактных схем предложен С. В. Яблонским и И. А. Чегис в [2]. Представим, что имеется контактная схема S , реализующая булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, где $\tilde{x}^n = (x_1, \dots, x_n)$. Под воздействием некоторого источника неисправностей один или несколько контактов схемы S могут перейти в неисправное состояние. В качестве неисправностей контактов обычно рассматриваются их обрывы и замыкания. При обрыве контакта проводимость между его концами становится тождественно нулевой, а при замыкании — тождественно единичной. В результате схема S вместо исходной функции $f(\tilde{x}^n)$ будет реализовывать некоторую булеву функцию $g(\tilde{x}^n)$, вообще говоря, отличную от f . Все такие функции $g(\tilde{x}^n)$, получающиеся при всевозможных допустимых для рассматриваемой задачи неисправностях контактов схемы S , называются *функциями неисправности* данной схемы.

Введём следующие определения [3, 4, 5]. *Проверяющим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, \dots, x_n , что для любой отличной от $f(\tilde{x}^n)$ функции неисправности $g(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\sigma}$, на котором $f(\tilde{\sigma}) \neq g(\tilde{\sigma})$. *Диагностическим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, \dots, x_n , что T является проверяющим тестом и, кроме того, для любых двух различных функций неисправности $g_1(\tilde{x}^n)$ и $g_2(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдётся набор $\tilde{\sigma}$, на котором $g_1(\tilde{\sigma}) \neq g_2(\tilde{\sigma})$. Число наборов в T называется *длиной* теста. В качестве тривиального диагностического (и проверяющего) теста длины 2^n для схемы S всегда можно взять множество, состоящее из всех двоичных наборов длины n . Тест называется *полным*, если в схеме могут быть неисправны сколько угодно контактов, и *единичным*, если в схеме может быть неисправен только один контакт. Единичные тесты обычно рассматривают для *неизбыточных схем* [5], т. е. для таких схем, в которых любая допустимая неисправность любого одного контакта приводит к функции неисправности, отличной от исходной функции, реализуемой данной схемой.

В дальнейшем будем считать, что в схемах могут происходить как обрывы, так и замыкания контактов независимо друг от друга.

Пусть множество T является единичным проверяющим тестом (ЕПТ) для некоторой контактной схемы S . Введём следующие обозначения: $D_{\text{ЕП}}(T)$ — длина теста T ; $D_{\text{ЕП}}(S) = \min D_{\text{ЕП}}(T)$, где минимум берётся по всем ЕПТ T для контактной схемы S ; $D_{\text{ЕП}}(f) = \min D_{\text{ЕП}}(S)$, где минимум берётся по всем избыточным контактным схемам S , реализующим функцию f ; $D_{\text{ЕП}}(n) = \max D_{\text{ЕП}}(f)$, где максимум берётся по всем булевым функциям f от n переменных. Функция $D_{\text{ЕП}}(n)$ называется *функцией Шеннона* длины ЕПТ. По аналогии с функциями $D_{\text{ЕП}}$ можно ввести функции $D_{\text{ЕД}}$, $D_{\text{ПП}}$ и $D_{\text{ПД}}$ для соответственно единичного диагностического, полного проверяющего и полного диагностического тестов, зависящие от T , от S , от f и от n (в определениях функций $D_{\text{ПП}}(f)$ и $D_{\text{ПД}}(f)$ не предполагается избыточности схем). Так, например, $D_{\text{ПД}}(n)$ — функция Шеннона длины полного диагностического теста.

Перечислим основные результаты, касающиеся задачи синтеза легкотестируемых контактных схем при рассматриваемых неисправностях. В [5, с. 113, теорема 9] с использованием идей С. В. Яблонского установлено, что функция $D_{\text{ЕД}}(n)$ асимптотически не превосходит $\frac{2^{n+1}}{n}$. Х. А. Мадатян в [6] доказал равенство $D_{\text{ПД}}(n) = 2^n$, а в [7] — соотношение

$D_{\text{ЕП}}(n) = O\left(\frac{2^n}{n\sqrt{n}}\right)$. Н. П. Редькин в [8] получил оценку $D_{\text{ПП}}(n) \leq \frac{15}{16} \cdot 2^n$. Из утверждения 2) теоремы 1 работы [9] следует, что для любой булевой функции $f(\tilde{x}^n)$ вида $\varphi(\tilde{x}^{n-1}) \oplus x^n$, где $\varphi(\tilde{x}^{n-1})$ — произвольная неконстантная булева функция, существует неизбыточная контактная схема, содержащая, помимо переменных из множества $\{x_1, \dots, x_n\}$, дополнительную входную переменную x_0 , допускающая ЕПТ длины $4n + 8$ и реализующая булеву функцию, не зависящую существенно от переменной x_0 и равную функции $f(\tilde{x}^n)$. В работе [10], в частности, доказано (теорема 4), что для любой булевой функции $f(\tilde{x}^n)$ существует неизбыточная контактная схема, содержащая не более пяти дополнительных входных переменных, допускающая ЕПТ длины не более 35 и реализующая такую булеву функцию, что $f(\tilde{x}^n)$ получается из неё подстановкой вместо этих дополнительных переменных некоторых булевых констант. В работах автора [11, 12, 13] рассмотрены задачи синтеза легкотестируемых контактных схем только при замыканиях либо только при обрывах (размыканиях) контактов.

Будем говорить, что некоторое свойство выполняется *для почти всех булевых функций от n переменных*, если отношение числа булевых функций от n переменных, для которых это свойство не выполняется, к числу всех булевых функций от n переменных (т. е. к 2^{2^n}) стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$.

Далее будут рассматриваться только ЕПТ. Будут описаны все булевы функции f , для которых величина $D_{\text{ЕП}}(f)$ равна 0, 1, 2 и 3 (теорема 1), а также достаточно обширный класс булевых функций f , для которых она равна 4 (теорема 2); будет показано, что в этом классе содержатся почти все булевы функции от n переменных (теорема 3).

В дальнейшем нижний индекс ЕП у буквы D для краткости будем опускать.

2. Родственные функции

Введём обозначение

$$\alpha^\beta = \begin{cases} \alpha, & \text{если } \beta = 1, \\ \bar{\alpha}, & \text{если } \beta = 0, \end{cases}$$

где $\alpha \in \{0, 1\}$.

Заметим, что

$$\alpha^\beta = \alpha \oplus \beta \oplus 1. \tag{1}$$

Назовём булеву функцию $f_2(\tilde{x}^n)$ родственной булевой функции $f_1(\tilde{x}^n)$, если существуют такие попарно различные индексы i_1, \dots, i_n от 1 до n и такие булевы константы $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, что $f_2(\tilde{x}^n) = f_1(x_{i_1}^{\sigma_1}, \dots, x_{i_n}^{\sigma_n})$.

Например, любая из функций $x_1\bar{x}_2, x_1x_3, \bar{x}_2\bar{x}_3, x_3\bar{x}_4$ родственна функции x_1x_2 , если все эти функции рассматриваются как функции от переменных x_1, \dots, x_n , где $n \geq 4$.

Отметим, что если булева функция $f_2(\tilde{x}^n)$ родственна булевой функции $f_1(\tilde{x}^n)$, то $f_1(\tilde{x}^n)$ родственна $f_2(\tilde{x}^n)$. Действительно, пусть попарно различные индексы j_1, \dots, j_n от 1 до n таковы, что $j_{i_1} = 1, \dots, j_{i_n} = n$; тогда

$$f_2(x_{j_1}^{\sigma_1}, \dots, x_{j_n}^{\sigma_n}) = f_1\left(\left(x_{j_{i_1}}^{\sigma_1}\right)^{\sigma_1}, \dots, \left(x_{j_{i_n}}^{\sigma_n}\right)^{\sigma_n}\right) = f_1(\tilde{x}^n),$$

т. е. $f_1(\tilde{x}^n)$ родственна $f_2(\tilde{x}^n)$.

Далее для краткости всюду вместо «закрывающий (размыкающий) контакт, отвечающий переменной x_i », будем говорить «контакт x_i » (соответственно «контакт \bar{x}_i »).

Лемма 1. Пусть булева функция $f_2(\tilde{x}^n)$ родственна булевой функции $f_1(\tilde{x}^n)$. Тогда $D(f_2) = D(f_1)$.

Доказательство. По определению существуют такие попарно различные индексы i_1, \dots, i_n от 1 до n и такие булевы константы $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, что $f_2(\tilde{x}^n) = f_1(x_{i_1}^{\sigma_1}, \dots, x_{i_n}^{\sigma_n})$. Пусть S_1 — такая неизбыточная контактная схема, реализующая функцию f_1 , а T_1 — такой ЕПТ для этой схемы, что $D(T_1) = D(S_1) = D(f_1)$. Для любых $j \in \{1, \dots, n\}$, $\beta \in \{0, 1\}$ заменим в схеме S каждый контакт x_j^β на контакт $x_{i_j}^{\beta \oplus \sigma_j \oplus 1}$; указанные два контакта поставим в соответствие друг другу. Полученную схему обозначим через S_2 . На любом двоичном наборе $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ каждый контакт $x_{i_j}^{\beta \oplus \sigma_j \oplus 1}$ схемы S_2 функционирует в точности так же, как соответствующий ему контакт x_j^β схемы S_1 на наборе $(\alpha_{i_1}^{\sigma_1}, \dots, \alpha_{i_n}^{\sigma_n})$, поскольку

$$\alpha_{i_j}^{\beta \oplus \sigma_j \oplus 1} = \alpha_{i_j} \oplus (\beta \oplus \sigma_j \oplus 1) \oplus 1 = (\alpha_{i_j} \oplus \sigma_j \oplus 1) \oplus \beta \oplus 1 = (\alpha_{i_j}^{\sigma_j})^\beta$$

в силу (1). Отсюда следует, что схема S_2 при отсутствии в ней неисправностей выдаёт на наборе $\tilde{\alpha}$ значение $f_1(\alpha_{i_1}^{\sigma_1}, \dots, \alpha_{i_n}^{\sigma_n}) = f_2(\tilde{\alpha})$, т. е. реализует функцию $f_2(\tilde{x}^n)$.

Пусть T_2 — множество двоичных наборов длины n , получающееся из множества T_1 заменой каждого набора $(\pi_{s,i_1}, \dots, \pi_{s,i_n})$ (для удобства

занумеруем его компоненты именно так), принадлежащего T_1 , на набор $(\pi_{s,1}^{\sigma_1}, \dots, \pi_{s,n}^{\sigma_n})$. Докажем, что схема S_2 избыточна и допускает ЕПТ T_2 . Рассмотрим произвольную неисправность любого одного контакта этой схемы. Такую же неисправность соответствующего контакта схемы S_1 можно обнаружить на каком-то наборе $\tilde{\pi}_s = (\pi_{s,i_1}, \dots, \pi_{s,i_n}) \in T_1$, так как T_1 является ЕПТ для избыточной схемы S_1 . Значит, для получающейся функции неисправности $g(\tilde{x}^n)$ справедливо соотношение

$$g(\tilde{\pi}_s) \neq f_1(\tilde{\pi}_s). \quad (2)$$

Каждый контакт $x_{i_j}^{\beta \oplus \sigma_j \oplus 1}$ схемы S_2 на наборе $\tilde{\pi}'_s = (\pi_{s,1}^{\sigma_1}, \dots, \pi_{s,n}^{\sigma_n}) \in T_2$ при рассматриваемых неисправностях контактов в схемах S_1, S_2 функционирует так же, как соответствующий ему контакт x_j^β схемы S_1 на наборе $\tilde{\pi}_s$, поскольку

$$(\pi_{s,i_j}^{\sigma_j})^{\beta \oplus \sigma_j \oplus 1} = (\pi_{s,i_j} \oplus \sigma_j \oplus 1) \oplus (\beta \oplus \sigma_j \oplus 1) \oplus 1 = \pi_{s,i_j} \oplus \beta_i \oplus 1 = \pi_{s,i_j}^\beta$$

в силу (1). Отсюда следует, что схема S_2 выдаёт на наборе $\tilde{\pi}'_s$ значение $g(\tilde{\pi}_s)$, отличное от значения

$$f_1(\tilde{\pi}_s) = f_1((\pi_{s,i_1}^{\sigma_1})^{\sigma_1}, \dots, (\pi_{s,i_n}^{\sigma_n})^{\sigma_n}) = f_2(\tilde{\pi}'_s)$$

в силу (2), т. е. рассматриваемая неисправность схемы S_2 обнаруживается на наборе $\tilde{\pi}'_s \in T_2$. Из приведённых рассуждений вытекает, что схема S_2 избыточна и допускает ЕПТ T_2 , поэтому

$$D(f_2) \leq D(S_2) \leq D(T_2) = D(T_1) = D(f_1).$$

Тем самым доказано, что $D(f_2) \leq D(f_1)$. Аналогично доказывается неравенство $D(f_1) \leq D(f_2)$ (с учётом того, что функция $f_1(\tilde{x}^n)$ родственна функции $f_2(\tilde{x}^n)$). В итоге получаем равенство $D(f_2) = D(f_1)$. Лемма 1 доказана. \square

Двоичный набор $\tilde{\sigma}$ длины n будем называть *единичным (нулевым)* набором булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, если $f(\tilde{\sigma}) = 1$ (соответственно, $f(\tilde{\sigma}) = 0$).

3. Схемы, допускающие тесты длины не более 3

Опишем вначале все булевы функции f , для которых $D(f) = 0$, $D(f) = 1$, $D(f) = 2$ и $D(f) = 3$.

Лемма 2. Для любой избыточной контактной схемы S , содержащей не менее трёх контактов, справедливо неравенство $D(S) \geq 4$.

Доказательство. Рассмотрим четыре случая.

1. Полюса схемы S совпадают. Тогда она, очевидно, реализует константу 1 как при отсутствии в ней неисправностей, так и при любой неисправности любого её контакта, поэтому избыточна; противоречие.

2. Все контакты схемы S принадлежат некоторой несамопересекающейся цепи C , соединяющей её полюса. Если в этой цепи присутствуют одновременно замыкающий и размыкающий контакт одной и той же переменной, то схема S , очевидно, реализует константу 0 как при отсутствии в ней неисправностей, так и при обрыве любого из контактов цепи C , поэтому избыточна. Если в цепи C присутствуют два замыкающих или два размыкающих контакта одной и той же переменной, то при замыкании любого одного из них, как нетрудно видеть, функция, реализуемая схемой S , не изменится, поэтому схема избыточна. Далее можно считать, что все контакты схемы S отвечают разным переменным. Пусть это контакты $x_1^{\sigma_1}, \dots, x_n^{\sigma_n}$, где $n \geq 3$. Тогда рассматриваемая схема при отсутствии в ней неисправностей реализует функцию $f = x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}$, при обрыве любого контакта — функцию $g_0 \equiv 0$, а при замыкании контакта $x_i^{\sigma_i}$ — функцию $g_i = x_1^{\sigma_1} \dots x_{i-1}^{\sigma_{i-1}} x_{i+1}^{\sigma_{i+1}} \dots x_n^{\sigma_n}$ для $i = 1, \dots, n$. Функция $f(\tilde{x}^n)$ отличается от функции $g_0(\tilde{x}^n)$ только на наборе $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, а от функции $g_i(\tilde{x}^n)$ — только на наборе $(\sigma_1, \dots, \sigma_{i-1}, \bar{\sigma}_i, \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_n)$, где $i = 1, \dots, n$, поэтому в любой ЕПТ для схемы S должны входить все указанные $n + 1 \geq 4$ наборов, откуда следует неравенство $D(S) \geq 4$.

3. Полюса схемы S не совпадают и каждый контакт в ней соединяет её полюса. Если среди этих контактов присутствуют одновременно замыкающий и размыкающий контакт одной и той же переменной, то схема S , очевидно, реализует константу 1 как при отсутствии в ней неисправностей, так и при замыкании любого из её контактов, поэтому избыточна. Если в ней присутствуют два замыкающих или два размыкающих контакта одной и той же переменной, то при обрыве любого одного из них, как нетрудно видеть, функция, реализуемая схемой S , не изменится, поэтому схема избыточна. Далее можно считать, что все контакты схемы S отвечают разным переменным. Пусть это контакты $x_1^{\sigma_1}, \dots, x_n^{\sigma_n}$, где $n \geq 3$. Тогда рассматриваемая схема при отсутствии в ней неисправностей реализует функцию $f = x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}$, при замыкании любого контакта — функцию $g_0 \equiv 1$, а при обрыве контакта $x_i^{\sigma_i}$ — функцию $g_i = x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_{i-1}^{\sigma_{i-1}} \vee x_{i+1}^{\sigma_{i+1}} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}$ для $i = 1, \dots, n$. Функция $f(\tilde{x}^n)$ отличается от функции $g_0(\tilde{x}^n)$ только на наборе $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$, а

от функции $g_i(\tilde{x}^n)$ — только на наборе $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{i-1}, \sigma_i, \bar{\sigma}_{i+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$, где $i = 1, \dots, n$, поэтому в любой ЕПТ для схемы S должны входить все указанные $n + 1 \geq 4$ наборов, откуда следует неравенство $D(S) \geq 4$.

4. Отрицание объединения случаев 1–3: полюса схемы S не совпадают, не все её контакты принадлежат одной и той же несамопересекающейся цепи и в схеме S есть контакт K , хотя бы один конец которого отличен от полюсов схемы. Пусть схема S при отсутствии в ней неисправностей реализует функцию $f(\tilde{x}^n)$, и пусть T — произвольный ЕПТ для данной схемы. При замыкании любого её контакта функция, реализуемая схемой S , не может уменьшиться, поэтому данная неисправность может обнаруживаться только на нулевых наборах функции f , откуда следует, что в тесте T содержится хотя бы один нулевой набор $\tilde{\sigma}_0$ этой функции. Предположим, что это единственный нулевой набор функции f , содержащийся в T . Тогда ни один контакт схемы S не может проводить на наборе $\tilde{\sigma}_0$, поскольку в противном случае замыкание проводящего на этом наборе контакта нельзя было бы обнаружить на наборах из T . Замыкание контакта K должно обнаруживаться на наборе $\tilde{\sigma}_0$, т. е. в полученной схеме должна быть цепь между полюсами, проводящая на указанном наборе. Но единственным проводящим в этой схеме на наборе $\tilde{\sigma}_0$ контактом является K , следовательно, он соединяет полюса схемы; противоречие. Тем самым доказано, что в T содержатся хотя бы два нулевых набора функции f .

Далее, при обрыве любого контакта схемы S функция, реализуемая этой схемой, не может увеличиться, поэтому данная неисправность может обнаруживаться только на единичных наборах функции f , откуда следует, что в тесте T содержится хотя бы один единичный набор $\tilde{\sigma}_1$ этой функции. Пусть C — произвольная проводящая на этом наборе несамопересекающаяся цепь между полюсами схемы S . По предположению случая 4 в данной схеме присутствует хотя бы один контакт, не принадлежащий цепи C . Тогда при обрыве этого контакта в схеме S цепь C по-прежнему будет проводить на наборе $\tilde{\sigma}_1$ и схема на данном наборе выдаст значение $1 = f(\tilde{\sigma}_1)$. Это означает, что в тесте T должен содержаться ещё какой-то единичный набор функции f , отличный от $\tilde{\sigma}_1$, на котором обнаруживается обрыв указанного контакта. В итоге получаем, что в любой ЕПТ для схемы S должны входить хотя бы четыре набора, откуда следует неравенство $D(S) \geq 4$. Лемма 2 доказана. \square

Теорема 1. Пусть $f(\tilde{x}^n)$ — булева функция. Справедливо равенство

$$D(f) = \begin{cases} 0, & \text{если } f \equiv 0 \text{ или } f \equiv 1, \\ 2, & \text{если } f \text{ родственна функции } x_1, \\ 3, & \text{если } f \text{ родственна одной из функций } x_1x_2, x_1 \vee x_2. \end{cases}$$

В остальных случаях $D(f) \geq 4$.

Следствие 1. Для любого $n \geq 2$ справедливо неравенство $D(n) \geq 4$.

Доказательство теоремы 1. В случаях $f \equiv 0$, $f \equiv 1$ функцию f можно реализовать контактной схемой, не содержащей ни одного контакта. У такой схемы нет ни одной функции неисправности, поэтому пустое множество является для неё ЕПТ, откуда следует равенство $D(f) = 0$. В случае $f = x_1$ функцию f можно реализовать контактной схемой, содержащей ровно один контакт. При обрыве (замыкании) этого контакта схема станет реализовывать константу 0 (соответственно, константу 1), которую можно отличить от функции f на любом наборе, первая компонента которого равна 1 (соответственно, 0), поэтому $D(f) \leq 2$. С другой стороны, в любой избыточной контактной схеме S , реализующей функцию f , должен содержаться хотя бы один контакт; при обрыве (замыкании) этого контакта реализуемая схемой функция не может увеличиться (соответственно, уменьшиться), поэтому для обнаружения указанной неисправности в любом ЕПТ T для схемы S должен содержаться хотя бы один единичный (соответственно, нулевой) набор функции f . Отсюда следует неравенства $D(T) \geq 2$, $D(S) \geq 2$ и $D(f) \geq 2$, а вместе с последним из них равенство $D(f) = 2$, т. е. $D(x_1) = 2$.

Если функция $f(\tilde{x}^n)$ родственна функции x_1 , то $D(f) = 2$ в силу леммы 1.

Пусть $f = x_1x_2$. Докажем равенство $D(f) = 3$. Реализуем функцию f схемой $S_{\&}$, представляющей собой цепь из двух контактов: x_1 и x_2 . Легко видеть, что всевозможными функциями неисправности такой схемы являются функции $g_0 \equiv 0$, $g_1 = x_1$ и $g_2 = x_2$. Функция g_0 (функция g_1 , функция g_2) отличается от функции f в точности на всех таких наборах, первые две компоненты каждого из которых равны 1 и 1 соответственно (1 и 0 соответственно, 0 и 1 соответственно). Указанные три множества наборов попарно не пересекаются, а в любой ЕПТ для схемы $S_{\&}$ должно входить хотя бы по одному набору из каждого из них, поэтому $D(S_{\&}) \geq 3$. С другой стороны, выбрав по произвольному набору из каждого из этих множеств, получим ЕПТ длины 3 для схемы $S_{\&}$. Таким

образом, $D(S_{\&}) = 3$. Далее заметим, что единственной контактной схемой, содержащей не более двух контактов и реализующей функцию f (с точностью до перестановки полюсов), является схема $S_{\&}$, поэтому любая другая избыточная схема S' , реализующая эту функцию, содержит не менее трёх контактов и $D(S') \geq 4$ по лемме 2. В итоге получаем, что $D(f) = D(S_{\&}) = 3$, т. е. $D(x_1x_2) = 3$.

Пусть $f = x_1 \vee x_2$. Реализуем функцию f схемой S_{\vee} , представляющей собой параллельное соединение двух контактов: x_1 и x_2 . Дальнейшие рассуждения проводятся двойственным образом по отношению к рассуждениям из случая $f = x_1x_2$ (принцип двойственности см., например, в [14, с. 24]). В итоге получаем, что $D(x_1 \vee x_2) = 3$.

Если функция $f(\tilde{x}^n)$ родственна одной из функций x_1x_2 , $x_1 \vee x_2$, то $D(f) = 3$ в силу леммы 1.

Нетрудно заметить, что контактные схемы, содержащие не более двух контактов, могут реализовывать только булевы функции f , рассмотренные выше. Любая другая булева функция f может быть реализована только контактными схемами, содержащими не менее трёх контактов, откуда с учётом леммы 2 следует неравенство $D(f) \geq 4$. Теорема 1 доказана. \square

4. Схемы, допускающие тесты длины 4

Пусть $n \geq 2$. Назовём $L_{(n)}$ -блоком четырёхполюсную контактную схему с полюсами A_1 , A_2 , A_3 и A_4 , содержащую четыре контакта: контакт x_{t_1} между полюсами A_1 и A_3 , контакт x_{t_2} между полюсами A_2 и A_4 , контакт \bar{x}_{t_3} между полюсами A_2 и A_3 и контакт \bar{x}_{t_4} между полюсами A_1 и A_4 , где либо $t_1, t_2, t_3, t_4 \in \{1, \dots, n-1\}$, либо $t_1 = t_2 = t_3 = t_4 = n$ (см. рис. 1). Для удобства будем обозначать такой $L_{(n)}$ -блок через $B_{t_3, t_4}^{t_1, t_2}$.

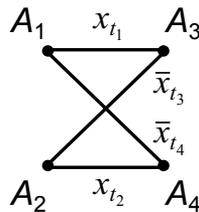


Рис. 1. $L_{(n)}$ -блок

Назовём $L_{(n)}$ -схемой четырёхполосную контактную схему S с полюсами a_0, b_0, a_m и b_m , составленную из произвольных $L_{(n)}$ -блоков B_1, \dots, B_m для произвольного $m \in \mathbb{N}$ следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 блока B_1 ; для любого $i \in \{1, \dots, m-1\}$ полюса A_3 и A_4 блока B_i совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 блока B_{i+1} и для удобства объявляются вершинами соответственно a_i и b_i схемы; полюса a_m и b_m схемы S совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока B_m (см. рис. 2). Наличие буквы L в названии « $L_{(n)}$ -схема» обусловлено тем, что похожее строение имеет известная схема, реализующая линейную булеву функцию $x_1 \oplus \dots \oplus x_n$ и содержащая $4n - 4$ контактов (см., например, [1, с. 44, рис. 21]).

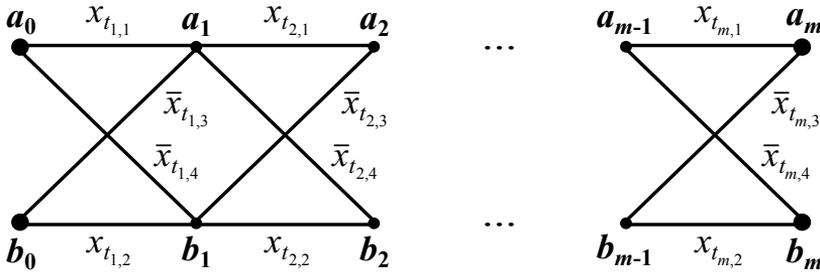


Рис. 2. $L_{(n)}$ -схема

Пусть S — произвольная $L_{(n)}$ -схема, составленная из чётного числа m $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ также чётно. Назовём $L'_{(n)}$ -схемой контактную схему с полюсами b_0 и a_m , получающуюся из схемы S добавлением вершины c_1 и соединением её с полюсами b_m и a_0 схемы S контактами x_1 и x_n соответственно, а также добавлением вершины c_2 и соединением её с полюсами b_m и a_0 схемы S контактами \bar{x}_1 и \bar{x}_n соответственно (см. рис. 3).

Введём обозначения $\tilde{0}^l = \underbrace{0, \dots, 0}_l$, $\tilde{1}^l = \underbrace{1, \dots, 1}_l$, где $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

(В случае $l = 0$ они обозначают пустую строку: например, $(\tilde{0}^0, 1, \tilde{0}^{n-1}) = (1, \tilde{0}^{n-1})$.)

Лемма 3. Любая $L'_{(n)}$ -схема избыточна и допускает ЕПТ $T = \{(\tilde{0}^n), (\tilde{0}^{n-1}, 1), (\tilde{1}^{n-1}, 0), (\tilde{1}^n)\}$; при этом в случае отсутствия в ней неисправностей она проводит на наборах $(\tilde{0}^n)$ и $(\tilde{1}^n)$ и не проводит на наборах $(\tilde{0}^{n-1}, 1)$ и $(\tilde{1}^{n-1}, 0)$.

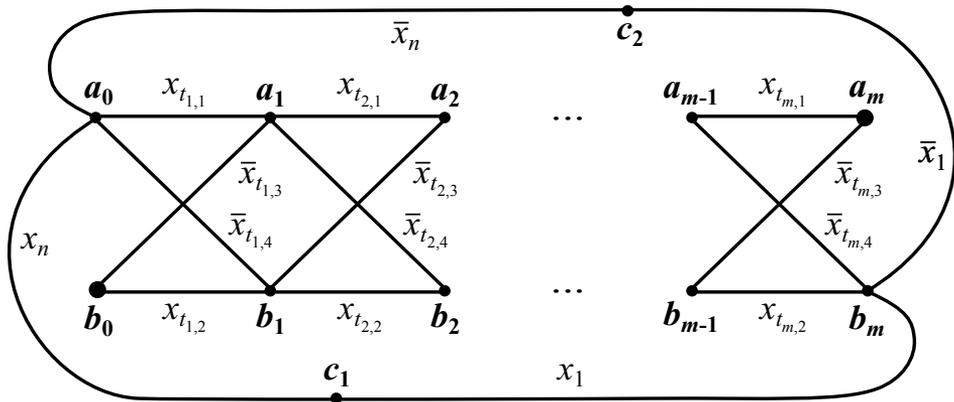


Рис. 3. $L'_{(n)}$ -схема

Доказательство. Пусть S' — произвольная $L'_{(n)}$ -схема, и пусть она при отсутствии неисправностей реализует между своими полюсами булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$ и получена из некоторой $L_{(n)}$ -схемы S способом, указанным в определении $L'_{(n)}$ -схемы; в свою очередь, схема S состоит из $L_{(n)}$ -блоков B_1, \dots, B_m для некоторого чётного m , среди которых число μ блоков вида $B_{n,n}^{\mu}$ также чётно; в случае $\mu \geq 2$ обозначим номера этих μ блоков в порядке возрастания через i_1, \dots, i_μ . Докажем, что схема S' неизбыточна и допускает ЕПТ T . Для этого достаточно доказать, что любая неисправность (обрыв или замыкание) любого одного контакта данной схемы обнаруживается на каком-то наборе из множества T . Рассмотрим произвольную такую неисправность. Нетрудно видеть, что все замыкающие (размыкающие) контакты схемы S' принадлежат несамопересекающейся цепи $b_0 - b_1 - \dots - b_m - c_1 - a_0 - a_1 - \dots - a_m$ (соответственно, $b_0 - a_1 - b_2 - \dots - a_{m-1} - b_m - c_2 - a_0 - b_1 - a_2 - \dots - b_{m-1} - a_m$; здесь используется, что m чётно), соединяющей полюса схемы. Поэтому при отсутствии неисправностей схема S' проводит на наборе $(\tilde{1}^n)$ (соответственно, $(\tilde{0}^n)$), а при обрыве произвольного её замыкающего (соответственно, размыкающего) контакта — не проводит на этом наборе. Таким образом, обрыв любого контакта данной схемы обнаруживается на одном из наборов $(\tilde{1}^n), (\tilde{0}^n) \in T$.

Далее, на наборе $(\tilde{1}^{n-1}, 0)$ в схеме S' в случае отсутствия в ней неисправностей проводят все контакты $x_1, \dots, x_{n-1}, \bar{x}_n$ и только они. Ни один блок из множества $\{B_1, \dots, B_m\} \setminus \{B_{i_1}, \dots, B_{i_\mu}\}$ в силу определения $L_{(n)}$ -

блока не содержит контактов переменной x_n (в случае $\mu = 0$ множество $\{B_{i_1}, \dots, B_{i_\mu}\}$ считаем пустым). Поэтому нетрудно видеть, что множество проводящих на наборе $(\tilde{I}^{n-1}, 0)$ контактов схемы S' представляет собой объединение двух непересекающихся и несамопересекающихся цепей: $b_0 - b_1 - \dots - b_{i_1-1} - a_{i_1} - a_{i_1+1} - \dots - a_{i_2-1} - b_{i_2} - b_{i_2+1} - \dots - a_{i_\mu-1} - b_{i_\mu} - b_{i_\mu+1} - \dots - b_m - c_1$ и $c_2 - a_0 - a_1 - \dots - a_{i_1-1} - b_{i_1} - b_{i_1+1} - \dots - b_{i_2-1} - a_{i_2} - a_{i_2+1} - \dots - b_{i_\mu-1} - a_{i_\mu} - a_{i_\mu+1} - \dots - a_m$ (здесь используется, что μ чётно; в случае $\mu = 0$ эти цепи вырождаются в $b_0 - b_1 - \dots - b_m - c_1$ и $c_2 - a_0 - a_1 - \dots - a_m$ соответственно. Везде в случае $i < j$ участок цепи $a_i - \dots - a_j$ или $b_i - \dots - b_j$ считаем пустым), причём полюса b_0 и a_m принадлежат разным цепям, а любой из контактов $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}, x_n$ этой схемы соединяет какую-то вершину одной из указанных цепей с какой-то вершиной другой. (Пример строения схемы S' при $m = 6, \mu = 2, i_1 = 3, i_2 = 5$ приведён на рис. 4; сплошными линиями выделены все контакты $x_1, \dots, x_{n-1}, \bar{x}_n$, а пунктирными — все контакты $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}, x_n$.) Отсюда следует, что при отсутствии неисправностей схема S' не проводит на наборе $(\tilde{I}^{n-1}, 0)$, а при замыкании любого из её контактов $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}, x_n$ — проводит на этом наборе. Таким образом, замыкание любого такого контакта данной схемы обнаруживается на наборе $(\tilde{I}^{n-1}, 0) \in T$.

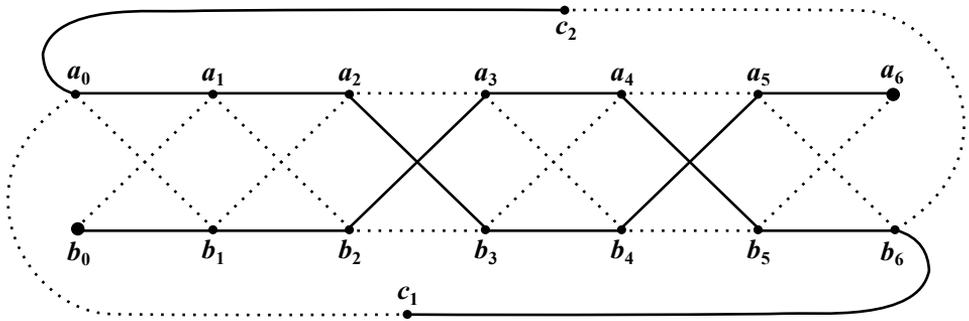


Рис. 4. Строение схемы S'

Осталось рассмотреть замыкание любого из контактов $x_1, \dots, x_{n-1}, \bar{x}_n$ схемы S' . Переобозначим вершины этой схемы — а именно, поменяем местами вершины a_i и b_i для каждого нечётного i от 1 до $m - 1$. Тогда схема S' примет вид, представленный на рис. 5. Дальнейшие рассуждения полностью совпадают с рассуждениями из предыдущего абзаца при замене набора $(\tilde{I}^{n-1}, 0)$ на набор $(\tilde{O}^{n-1}, 1)$, а контактов $x_1, \dots, x_{n-1}, \bar{x}_n$ — на контакты $\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}, x_n$ и наоборот. Получаем, что рассматриваемая

неисправность обнаруживается на наборе $(\tilde{0}^{n-1}, 1) \in T$, а при отсутствии неисправностей схема S' не проводит на этом наборе. Лемма 3 доказана.

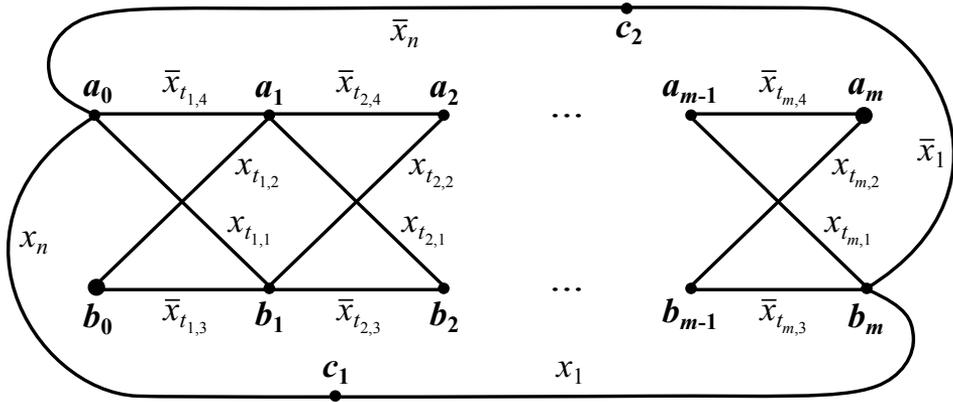


Рис. 5. Схема S' после переобозначения вершин

□

5. Изучение возможностей реализации булевых функций $L'_{(n)}$ -схемами

Дальнейшие рассуждения направлены на поиск булевых функций, которые могут быть реализованы $L'_{(n)}$ -схемами. С учётом леммы 3 для любой такой функции f выполнено соотношение $D(f) \leq 4$. Параллельно будем оценивать сверху сложность каждой из построенных схем, т.е. число контактов в ней, в зависимости от n .

Всюду в данном разделе считаем, что все контакты, содержащиеся в схемах, исправны.

Контакт, соединяющий произвольные две вершины v и v' контактной схемы, будем обозначать через $[v, v']$.

Два контакта будем называть *противоположными*, если один из них имеет вид x_i , а другой — вид \bar{x}_i , где $i \in \mathbb{N}$.

Под *длиной цепи* в контактной схеме будем понимать число содержащихся в этой цепи контактов.

Лемма 4. Для любого двоичного набора $\tilde{\alpha}$ длины $n-1$, $n \geq 3$, отличного от наборов $(\tilde{0}^{n-1})$ и $(\tilde{1}^{n-1})$, существует $L_{(n)}$ -схема $S_{\tilde{\alpha}}$, составленная из

$m = 2n - 5$ $L_{(n)}$ -блоков, содержащая только контакты переменных из множества $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ и обладающая следующими свойствами:

(i) на наборе $\tilde{\alpha}$ проводимость между полюсами схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ из любой из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , (b_0, a_m) отсутствует;

(ii) на наборе $\tilde{\alpha}$ есть проводимость между полюсами b_0 и b_m схемы $S_{\tilde{\alpha}}$;

(iii) на любом двоичном наборе $\tilde{\tau}$ длины $n - 1$, отличном от наборов $\tilde{\alpha}$, $(\tilde{0}^{n-1})$ и $(\tilde{1}^{n-1})$, в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ есть проводимости либо между полюсами из каждой из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , либо между полюсами из каждой из пар (b_0, a_m) , (b_0, b_m) ,

Доказательство. Пусть $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ и при этом $\alpha_{i_1} = \dots = \alpha_{i_q} = 1$, $\alpha_{i_{q+1}} = \dots = \alpha_{i_{n-1}} = 0$, где $q \in \{1, \dots, n - 2\}$, а i_1, \dots, i_{n-1} — попарно различные индексы от 1 до $n - 1$ (для определённости можно считать, что $i_1 < \dots < i_q$ и $i_{q+1} < \dots < i_{n-1}$). По определению $L_{(n)}$ -схема однозначно задаётся числом $m \in \mathbb{N}$ и $L_{(n)}$ -блоками B_1, \dots, B_m . Положим $m = 2n - 5$, $B_1 = B_{i_1, i_1}^{i_{n-1}, i_1}$; $B_{2j} = B_{i_j, i_{j+1}}^{i_{j+1}, i_j}$, $B_{2j+1} = B_{i_{j+1}, i_j}^{i_{j+1}, i_j}$ для каждого $j = 1, \dots, q - 1$ (при $q \geq 2$); $B_{2j} = B_{i_{j+1}, i_{j+2}}^{i_{j+2}, i_{j+1}}$, $B_{2j+1} = B_{i_{j+2}, i_{j+1}}^{i_{j+2}, i_{j+1}}$ для каждого $j = q, \dots, n - 3$ (при $q \leq n - 3$). Полученную $L_{(n)}$ -схему обозначим через $S_{\tilde{\alpha}}$ (её вид при $n = 5$, $\tilde{\alpha} = (1, 1, 0, 0)$ показан на рис. 6). Проверим выполнение для этой схемы свойств (i)–(iii).

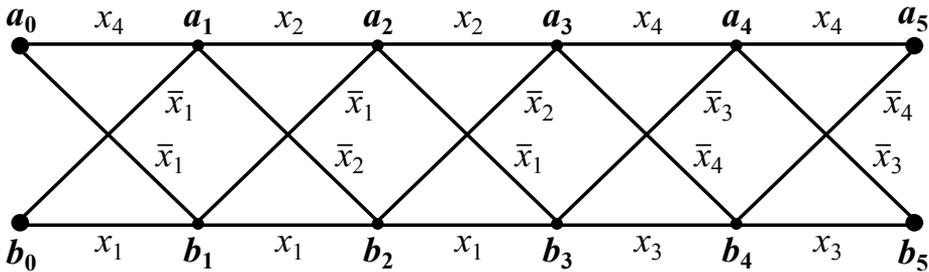


Рис. 6. Схема $S_{\tilde{\alpha}}$

Предположим, что свойство (i) не выполнено, т. е. в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ есть несамопересекающаяся цепь между её полюсами из какой-то из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , (b_0, a_m) , проводящая на наборе $\tilde{\alpha}$. Из всех таких цепей выберем цепь C наименьшей длины. Она не может соединять полюса a_0 и a_m , а также полюса a_0 и b_m , так как на наборе $\tilde{\alpha}$ ни один из контактов $[a_0, a_1]$, $[a_0, b_1]$ не проводит (в силу определения блока B_1 это контакты

$x_{i_{n-1}}, \bar{x}_{i_1}$ соответственно). Поэтому цепь C соединяет полюса b_0 и a_m схемы $S_{\tilde{\alpha}}$. Вершины этой цепи при движении от полюса b_0 к полюсу a_m обозначим через v_0, \dots, v_s , тогда $v_0 = b_0$ и $v_s = a_m$. Кроме того, $v_1 = b_1$, поскольку на наборе $\tilde{\alpha}$ контакт $[b_0, a_1]$ не проводит (это контакт \bar{x}_{i_1}). Также

$$v_1, \dots, v_s \notin \{a_0, b_0\} \quad (3)$$

в силу выбора цепи C .

Для удобства будем считать, что вершины a_d и b_d не принадлежат схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ для любого $d \geq m + 1$. Докажем, что $v_d \in \{a_d, b_d\}$ для любого $d \in \{0, \dots, s\}$ (в частности, $s \leq m$). Предположим противное. Пусть d — наименьший индекс от 0 до s , для которого $v_d \notin \{a_d, b_d\}$. Тогда $d \geq 2$, $v_{d-2} \in \{a_{d-2}, b_{d-2}\}$ и $v_{d-1} \in \{a_{d-1}, b_{d-1}\}$. Из последнего соотношения вытекает неравенство $d-1 \leq m$. Каждая из вершин a_{d-1}, b_{d-1} в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ соединена контактами с вершинами a_{d-2} и b_{d-2} , а также — в случае $d-1 < m$ — с вершинами a_d и b_d . Поэтому из соотношений $v_{d-1} \in \{a_{d-1}, b_{d-1}\}$ и $v_d \notin \{a_d, b_d\}$ следует, что $v_d \in \{a_{d-2}, b_{d-2}\}$; в частности, $d \geq 3$ в силу (3). Таким образом,

$$2 \leq d-1 \leq m = 2n-5. \quad (4)$$

Далее, из соотношений $v_{d-2} \in \{a_{d-2}, b_{d-2}\}$, $v_d \in \{a_{d-2}, b_{d-2}\}$ и того, что цепь C несамопересекающаяся, следует равенство $\{v_{d-2}, v_d\} = \{a_{d-2}, b_{d-2}\}$. Если $v_{d+1} \in \{a_{d-3}, b_{d-3}\}$, то на участке $v_{d+1} - \dots - v_s$ цепи C обязательно должна содержаться одна из вершин a_{d-2}, b_{d-2} , а значит, одна из вершин v_{d-2}, v_d , однако обе эти вершины уже содержатся на участке $v_0 - \dots - v_d$ данной цепи; противоречие. Поэтому $v_{d+1} \in \{a_{d-1}, b_{d-1}\}$. С учётом ранее установленного соотношения $v_{d-1} \in \{a_{d-1}, b_{d-1}\}$ получаем, что $\{v_{d-1}, v_{d+1}\} = \{a_{d-1}, b_{d-1}\}$. Значит, на участке $v_{d-2} - v_{d-1} - v_d - v_{d+1}$ цепи C чередуются вершины из множеств $\{a_{d-2}, b_{d-2}\}$ и $\{a_{d-1}, b_{d-1}\}$, причём на нём содержатся все вершины $a_{d-2}, b_{d-2}, a_{d-1}, b_{d-1}$, являющиеся полюсами $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{d-1} . Из (4) следует неравенство $n \geq 4$ и существование такого $j \in \{1, \dots, n-3\}$, что блок \mathbf{B}_{d-1} имеет один из видов $B_{i_j, i_{j+1}}^{i_{j+1}, i_j}$, $B_{i_{j+1}, i_j}^{i_j, i_{j+1}}$, $B_{i_{j+1}, i_{j+2}}^{i_{j+2}, i_{j+1}}$ или $B_{i_{j+2}, i_{j+1}}^{i_{j+2}, i_{j+1}}$. Заметим, что в блоке каждого из этих видов имеется по одному контакту $x_{i'}$, $x_{i''}$, $\bar{x}_{i'}$ и $\bar{x}_{i''}$ для некоторых $i', i'' \in \{i_j, i_{j+1}, i_{j+2}\}$, $i' \neq i''$. На участке $v_{d-2} - v_{d-1} - v_d - v_{d+1}$ цепи C содержатся три из этих четырёх контактов, поэтому какие-то два из указанных трёх контактов обязательно являются противоположными. Наличие противоположных контактов в данной цепи означает, что она не может проводить на наборе $\tilde{\alpha}$; противо-

речие. Тем самым доказано, что $v_d \in \{a_d, b_d\}$ для любого $d \in \{0, \dots, s\}$; в частности, $s \leq m$. Отсюда и из соотношения $v_s = a_m$ следует, что

$$s = m = 2n - 5,$$

т. е. $v_{2n-5} = a_{2n-5}$. Выше было показано, что $v_1 = b_1$ и $n \geq 4$. Поэтому существует такой индекс $j \in \{1, \dots, n-3\}$, что $v_{2j-1} = b_{2j-1}$ и $v_{2j+1} = a_{2j+1}$. Рассмотрим четыре случая.

1. Пусть $j \leq q-1$ и $v_{2j} = a_{2j}$. Тогда участок $v_{2j-1} - v_{2j} - v_{2j+1}$ цепи C имеет вид $b_{2j-1} - a_{2j} - a_{2j+1}$ и содержит контакты \bar{x}_{i_j} и $x_{i_{j+1}}$ из блоков B_{2j} и B_{2j+1} соответственно (см. определения этих блоков в начале доказательства леммы). Но $\alpha_{i_j} = 1$, поскольку $j \leq q$, следовательно, контакт \bar{x}_{i_j} , а вместе с ним и цепь C не могут проводить на наборе $\tilde{\alpha}$. Противоречие.

2. Пусть $j \leq q-1$ и $v_{2j} = b_{2j}$. Тогда участок $v_{2j-1} - v_{2j} - v_{2j+1}$ цепи C имеет вид $b_{2j-1} - b_{2j} - a_{2j+1}$ и содержит контакты x_{i_j} и $\bar{x}_{i_{j+1}}$ из блоков B_{2j} и B_{2j+1} соответственно. Но $\alpha_{i_{j+1}} = 1$, поскольку $j+1 \leq q$, следовательно, контакт $\bar{x}_{i_{j+1}}$, а вместе с ним и цепь C не могут проводить на наборе $\tilde{\alpha}$. Противоречие.

3. Пусть $j \geq q$ и $v_{2j} = a_{2j}$. Тогда участок $v_{2j-1} - v_{2j} - v_{2j+1}$ цепи C имеет вид $b_{2j-1} - a_{2j} - a_{2j+1}$ и содержит контакты $\bar{x}_{i_{j+1}}$ и $x_{i_{j+2}}$ из блоков B_{2j} и B_{2j+1} соответственно (см. определения этих блоков в начале доказательства леммы). Но $\alpha_{i_{j+2}} = 0$, поскольку $j+2 \geq q+1$, следовательно, контакт $x_{i_{j+2}}$, а вместе с ним и цепь C не могут проводить на наборе $\tilde{\alpha}$. Противоречие.

4. Пусть $j \geq q$ и $v_{2j} = b_{2j}$. Тогда участок $v_{2j-1} - v_{2j} - v_{2j+1}$ цепи C имеет вид $b_{2j-1} - b_{2j} - a_{2j+1}$ и содержит контакты $x_{i_{j+1}}$ и $\bar{x}_{i_{j+2}}$ из блоков B_{2j} и B_{2j+1} соответственно. Но $\alpha_{i_{j+1}} = 0$, поскольку $j+1 \geq q+1$, следовательно, контакт $x_{i_{j+1}}$, а вместе с ним и цепь C не могут проводить на наборе $\tilde{\alpha}$. Противоречие.

Во всех случаях получено противоречие, поэтому свойство (i) доказано.

Докажем промежуточное свойство (iv) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$, которое будет использоваться при доказательстве свойств (ii), (iii): функции проводимости между вершинами a_{2j-1} и $a_{2j'-1}$, а также между вершинами b_{2j-1} и $b_{2j'-1}$ в этой схеме тождественно равны 1 для любых $j, j' \in \{1, \dots, n-2\}$.

Достаточно доказать свойство (iv) для случая $j' = j+1$. Между вершинами a_{2j-1} и a_{2j+1} в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ есть, в частности, цепи $a_{2j-1} - a_{2j} -$

a_{2j+1} и $a_{2j-1} - b_{2j} - a_{2j+1}$. В силу определения блоков B_{2j} и B_{2j+1} первая из этих цепей содержит два контакта x_t , где

$$t = \begin{cases} i_{j+1}, & \text{если } j \leq q - 1, \\ i_{j+2}, & \text{если } j \geq q, \end{cases}$$

а вторая цепь — два контакта \bar{x}_t . Далее, между вершинами b_{2j-1} и b_{2j+1} в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ есть, в частности, цепи $b_{2j-1} - b_{2j} - b_{2j+1}$ и $b_{2j-1} - a_{2j} - b_{2j+1}$. В силу определения блоков B_{2j} и B_{2j+1} первая из этих цепей содержит два контакта $x_{t'}$, где

$$t' = \begin{cases} i_j, & \text{если } j \leq q - 1, \\ i_{j+1}, & \text{если } j \geq q, \end{cases}$$

а вторая цепь — два контакта $\bar{x}_{t'}$. Таким образом, функции проводимости между вершинами a_{2j-1} и $a_{2j'-1}$, а также между вершинами b_{2j-1} и $b_{2j'-1}$ в рассматриваемой схеме не меньше $x_t \vee \bar{x}_t \equiv 1$ и $x_{t'} \vee \bar{x}_{t'} \equiv 1$ соответственно, т. е. тождественно равны 1. Свойство (iv) доказано.

Докажем свойство (ii). В силу свойства (iv) и нечётности m достаточно доказать, что на наборе $\tilde{\alpha}$ есть проводимость между вершинами b_0 и b_1 схемы $S_{\tilde{\alpha}}$, а это утверждение очевидно, так как данные две вершины по определению блока B_1 соединены контактом x_{i_1} , проводящим на указанном наборе.

Докажем свойство (iii). Компоненты набора $\tilde{\tau}$ обозначим через $\tau_1, \dots, \tau_{n-1}$. Рассмотрим три случая.

1. Пусть $q \geq 2$ и $\tau_{i_j} \neq \tau_{i_{j+1}}$ для некоторого $j \in \{1, \dots, q-1\}$. В силу определения блока B_1 вершина b_1 в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ соединена с вершинами a_0 и b_0 контактами \bar{x}_{i_1} и x_{i_1} соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$. Поэтому достаточно доказать, что в этой схеме на указанном наборе есть проводимость между вершиной b_1 и каждой из вершин a_m, b_m . В силу свойства (iv) вершины b_1, a_m и b_m в предыдущем предложении можно заменить на b_{2j-1}, a_{2j+1} и b_{2j+1} соответственно. Проводимость между вершинами b_{2j-1} и b_{2j+1} есть по этому же свойству; исследуем проводимость между вершинами b_{2j-1} и a_{2j+1} . Между ними в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ есть, в частности, цепи $b_{2j-1} - a_{2j} - a_{2j+1}$ и $b_{2j-1} - b_{2j} - a_{2j+1}$. По определению блоков B_{2j} и B_{2j+1} первая из этих цепей содержит по одному контакту \bar{x}_{i_j} и $x_{i_{j+1}}$, а вторая цепь — по одному контакту x_{i_j} и $\bar{x}_{i_{j+1}}$. Одна из них проводит на наборе $\tilde{\tau}$, так как $\tau_{i_j} \neq \tau_{i_{j+1}}$. Случай 1 разобран.

2. Пусть $q \leq n-3$ и $\tau_{i_{j+1}} \neq \tau_{i_{j+2}}$ для некоторого $j \in \{q, \dots, n-3\}$. Так же, как в случае 1, достаточно доказать наличие проводимости между вершинами b_{2j-1} и a_{2j+1} в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ на наборе $\tilde{\tau}$. Между указанными вершинами есть, в частности, цепи $b_{2j-1} - a_{2j} - a_{2j+1}$ и $b_{2j-1} - b_{2j} - a_{2j+1}$. По определению блоков \mathbb{B}_{2j} и \mathbb{B}_{2j+1} первая из этих цепей содержит по одному контакту $\bar{x}_{i_{j+1}}$ и $x_{i_{j+2}}$, а вторая цепь — по одному контакту $x_{i_{j+1}}$ и $\bar{x}_{i_{j+2}}$. Одна из них проводит на наборе $\tilde{\tau}$, так как $\tau_{i_{j+1}} \neq \tau_{i_{j+2}}$. Случай 2 разобран.

3. Отрицание объединения случаев 1 и 2: пусть $\tau_{i_1} = \dots = \tau_{i_q}$ и $\tau_{i_{q+1}} = \dots = \tau_{i_{n-1}}$. Тогда $\tau_{i_1} = \dots = \tau_{i_q} = 0$ и $\tau_{i_{q+1}} = \dots = \tau_{i_{n-1}} = 1$, поскольку $\tilde{\tau} \notin \{\tilde{\alpha}, (\tilde{0}^{n-1}), (\tilde{1}^{n-1})\}$. В силу определения блока \mathbb{B}_1 вершина a_1 в схеме $S_{\tilde{\alpha}}$ соединена с вершинами a_0 и b_0 контактами $x_{i_{n-1}}$ и \bar{x}_{i_1} соответственно, каждый из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$; кроме того, вершина b_1 соединена с вершинами a_0 и b_0 контактами \bar{x}_{i_1} и x_{i_1} соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$. Поэтому на указанном наборе есть проводимость либо между вершинами из каждой из пар (a_0, a_1) , (a_0, b_1) , либо между вершинами из каждой из пар (b_0, a_1) , (b_0, b_1) . Осталось заметить, что по свойству (iv) есть проводимость между вершинами a_1 и a_m , а также между вершинами b_1 и b_m . Случай 3 разобран. Свойство (iii), а вместе с ним лемма 4 доказаны. \square

Сложность построенной схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ равна $4(2n-5) = 8n-20$.

Лемма 5. Пусть $n \geq 3$; $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ — произвольные булевы константы, не все из которых равны между собой; $\tilde{\sigma}_0 = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 0)$, $\tilde{\sigma}_1 = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1)$ и M — одно из множеств $\{\tilde{\sigma}_0, \tilde{\sigma}_1\}$, $\{\tilde{\sigma}_0\}$, $\{\tilde{\sigma}_1\}$. Тогда существует $L_{(n)}$ -схема S_M , обладающая следующими свойствами:

(v) на любом наборе из множества M проводимость между полюсами схемы S_M из любой из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , (b_0, a_m) , (b_0, b_m) отсутствует;

(vi) на любом двоичном наборе $\tilde{\pi}$ длины n , не принадлежащем множеству $M \cup \{(\tilde{0}^n), (\tilde{0}^{n-1}, 1), (\tilde{1}^{n-1}, 0), (\tilde{1}^n)\}$, в схеме S_M есть проводимость либо между полюсами из каждой из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , либо между полюсами из каждой из пар (b_0, a_m) , (b_0, b_m) .

Доказательство. Пусть $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$, а i и j — такие индексы от 1 до $n-1$, что $\alpha_i = 1$ и $\alpha_j = 0$. По лемме 4 существует $L_{(n)}$ -схема $S_{\tilde{\alpha}}$, составленная из $2n-5$ $L_{(n)}$ -блоков, содержащая только контакты переменных из множества $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ и обладающая свойствами (i)–(iii). Пусть $\tilde{\pi} = (\tau_1, \dots, \tau_n)$ (в формулировке свойства (vi)) и $\tilde{\tau} = (\tau_1, \dots, \tau_{n-1})$.

Тогда

$$\tilde{\tau} \notin \{(\tilde{0}^{n-1}), (\tilde{1}^{n-1})\}. \quad (5)$$

Рассмотрим два случая.

1. Пусть $M = \{\tilde{\sigma}_0, \tilde{\sigma}_1\}$. Определим $L_{(n)}$ -схему S_M следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S_M совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы $S_{\tilde{\alpha}}$; полюса a_{2n-5} и b_{2n-5} схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока B_m вида $B_{i,j}^{i,j}$, где $m = 2n - 4$; полюса a_m и b_m схемы S_M совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока B_m (см. рис. 7).

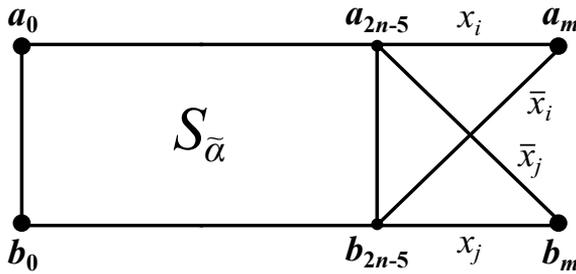


Рис. 7. Схема S_M в случае 1

Предположим, что свойство (v) не выполнено, т. е. в схеме S_M есть несамопересекающаяся цепь C между её полюсами из какой-то из пар (a_0, a_m) , (a_0, b_m) , (b_0, a_m) , (b_0, b_m) , проводящая на наборе $\tilde{\sigma}_\beta$ для некоторого $\beta \in \{0, 1\}$. Пусть $v \in \{a_0, b_0\}$ — один из концов этой цепи. Очевидно, что в ней можно выделить максимальный по длине участок, начинающийся с вершины v , содержащийся целиком в подсхеме $S_{\tilde{\alpha}}$ и проходящий через какую-то вершину $v' \in \{a_{2n-5}, b_{2n-5}\}$. Из свойства (i) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ и того, что первые $n - 1$ компонент наборов $\tilde{\sigma}_\beta$ и $\tilde{\alpha}$ совпадают, вытекает, что обязательно $v = b_0$, $v' = b_{2n-5}$. Вершина v' в силу максимальной выделенного участка инцидентна в цепи C некоторому контакту, не лежащему в подсхеме $S_{\tilde{\alpha}}$, а значит, принадлежащему блоку B_m . Это один из контактов $[b_{2n-5}, a_m]$, $[b_{2n-5}, b_m]$, т. е. один из контактов \bar{x}_i , x_j . Но ни один из них не проводит на наборе $\tilde{\sigma}_\beta$, поскольку $\alpha_i = 1$ и $\alpha_j = 0$; противоречие. Свойство (v) доказано.

Докажем свойство (vi). Заметим, что $\tilde{\tau} \notin \{\tilde{\alpha}, (\tilde{0}^{n-1}), (\tilde{1}^{n-1})\}$ в силу (5) и соотношения $\tilde{\pi} \notin M$. Отсюда, из свойства (iii) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ и того, что первые $n - 1$ компонент наборов $\tilde{\pi}$ и $\tilde{\tau}$ совпадают, следует, что в этой

схеме есть проводимость на наборе $\tilde{\pi}$ между полюсами из каждой из пар $(w, a_{2n-5}), (w, b_{2n-5})$ для некоторого $w \in \{a_0, b_0\}$. В силу определения блока \mathbf{B}_m вершина a_m соединена с вершинами a_{2n-5} и b_{2n-5} контактами x_i и \bar{x}_i соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$; вершина b_m соединена с вершинами a_{2n-5} и b_{2n-5} контактами \bar{x}_j и x_j соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$. Поэтому на указанном наборе есть проводимость между вершиной w и каждой из вершин a_m, b_m . Свойство (vi) доказано.

2. Пусть $M = \{\tilde{\sigma}_\beta\}$ для некоторого $\beta \in \{0, 1\}$. Определим $L_{(n)}$ -схему S_M следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S_M совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы $S_{\bar{\alpha}}$; полюса a_{2n-5} и b_{2n-5} схемы $S_{\bar{\alpha}}$ совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{m-1} вида $B_{n,n}^{n,n}$, где $m = 2n - 3$, и объявляются вершинами соответственно a_{m-1} и b_{m-1} схемы S_M ; полюса A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_{m-1} совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_m вида

$$\begin{cases} B_{i,j}^{i,j}, & \text{если } \beta = 1, \\ B_{j,i}^{j,i}, & \text{если } \beta = 0; \end{cases}$$

полюса a_m и b_m схемы S_M совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_m (вид этой схемы при $\beta = 1$ показан на рис. 8).

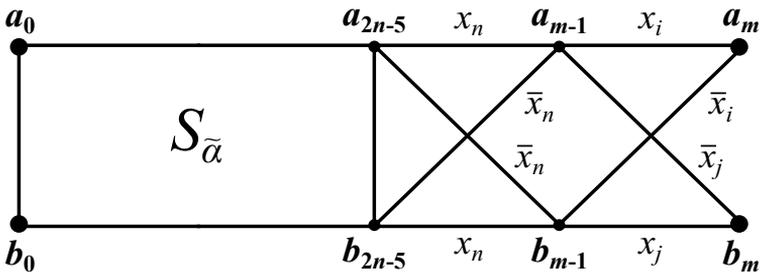


Рис. 8. Схема S_M в случае 2

Предположим, что свойство (v) не выполнено, т. е. в схеме S_M есть несамопересекающаяся цепь C между её полюсами из какой-то из пар $(a_0, a_m), (a_0, b_m), (b_0, a_m), (b_0, b_m)$, проводящая на наборе $\tilde{\sigma}_\beta$. Пусть $v \in \{a_0, b_0\}$ — один из концов этой цепи. Очевидно, что в ней можно выделить максимальный по длине участок, начинающийся с вершины v , содержащийся целиком в подсхеме $S_{\bar{\alpha}}$ и проходящий через какую-то

вершину $v' \in \{a_{2n-5}, b_{2n-5}\}$. Из свойства (i) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ и того, что первые $n - 1$ компонент наборов $\tilde{\sigma}_\beta$ и $\tilde{\alpha}$ совпадают, вытекает, что обязательно $v = b_0$, $v' = b_{2n-5}$. Вершина v' в силу максимальности выделенного участка инцидентна в цепи C некоторому контакту K , не лежащему в подсхеме $S_{\tilde{\alpha}}$. Это один из контактов $[b_{2n-5}, a_{m-1}]$, $[b_{2n-5}, b_{m-1}]$, принадлежащий блоку \mathbf{V}_{m-1} , т. е. один из контактов \bar{x}_n, x_n . Из них на наборе $\tilde{\sigma}_\beta$ проводит только контакт x_n^β ; таким образом, K — это контакт x_n^β . Рассмотрим два подслучая.

2.1. Пусть $\beta = 1$. Тогда контакт K соединяет вершины b_{2n-5} и b_{m-1} цепи C . Вершина b_{m-1} инцидентна в ней ещё одному контакту. В силу строения схемы S_M это один из контактов $[b_{m-1}, a_{2n-5}]$, $[b_{m-1}, a_m]$, $[b_{m-1}, b_m]$, т. е. один из контактов $\bar{x}_n, \bar{x}_i, x_j$ (см. определения блоков \mathbf{V}_{m-1} и \mathbf{V}_m). Но ни один из них не проводит на наборе $\tilde{\sigma}_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \beta)$, поскольку $\beta = 1$, $\alpha_i = 1$ и $\alpha_j = 0$; противоречие.

2.2. Пусть $\beta = 0$. Тогда контакт K соединяет вершины b_{2n-5} и a_{m-1} цепи C . Вершина a_{m-1} инцидентна в ней ещё одному контакту. В силу строения схемы S_M это один из контактов $[a_{m-1}, a_{2n-5}]$, $[a_{m-1}, a_m]$, $[a_{m-1}, b_m]$, т. е. один из контактов x_n, x_j, \bar{x}_i (см. определения блоков \mathbf{V}_{m-1} и \mathbf{V}_m). Но ни один из них не проводит на наборе $\tilde{\sigma}_\beta = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \beta)$, поскольку $\beta = 0$, $\alpha_i = 1$ и $\alpha_j = 0$; противоречие. Свойство (v) доказано.

Докажем свойство (vi). Пусть вначале $\tilde{\pi} \neq \tilde{\sigma}_\beta$. Заметим, что $\tilde{\pi} \neq \tilde{\sigma}_\beta$, так как $\tilde{\pi} \notin M$. Тогда $\tilde{\tau} \notin \{\tilde{\alpha}, (\tilde{0}^{n-1}), (\tilde{1}^{n-1})\}$ в силу (5) и соотношения $\tilde{\pi} \notin \{\tilde{\sigma}_\beta, \tilde{\sigma}_{\bar{\beta}}\}$. Отсюда, из свойства (iii) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ и того, что первые $n - 1$ компонент наборов $\tilde{\pi}$ и $\tilde{\tau}$ совпадают, следует, что в этой схеме есть проводимость на наборе $\tilde{\pi}$ между полюсами из каждой из пар (w, a_{2n-5}) , (w, b_{2n-5}) для некоторого $w \in \{a_0, b_0\}$. По определению блока \mathbf{V}_{m-1} вершина a_{m-1} соединена с вершинами a_{2n-5} и b_{2n-5} контактами x_n и \bar{x}_n соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$; вершина b_{m-1} соединена с вершинами a_{2n-5} и b_{2n-5} контактами \bar{x}_n и x_n соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$. Поэтому на указанном наборе есть проводимость между вершиной w и каждой из вершин a_{m-1}, b_{m-1} . Далее, по определению блока \mathbf{V}_m вершина a_m соединена с вершинами a_{m-1} и b_{m-1} контактами соответственно x_i и \bar{x}_i в случае $\beta = 1$ и контактами соответственно x_j и \bar{x}_j в случае $\beta = 0$, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$; вершина b_m соединена с вершинами a_{m-1} и b_{m-1} контактами соответственно \bar{x}_j и x_j в случае $\beta = 1$ и контактами соответственно \bar{x}_i и x_i в случае $\beta = 0$, один из которых проводит на наборе $\tilde{\pi}$. Поэтому на

указанном наборе есть проводимость между вершиной w и каждой из вершин a_m, b_m , что и требовалось доказать.

Пусть теперь $\tilde{\pi} = \tilde{\sigma}_{\tilde{\beta}}$. Из свойства (ii) схемы $S_{\tilde{\alpha}}$ и того, что первые $n - 1$ компонент наборов $\tilde{\pi}$ и $\tilde{\alpha}$ совпадают, вытекает, что на наборе $\tilde{\pi}$ есть проводимость между полюсами b_0 и b_{2n-5} схемы $S_{\tilde{\alpha}}$. Рассмотрим два подслучая.

2.1. Пусть $\beta = 1$. Тогда $\tilde{\pi} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 0)$. На наборе $\tilde{\pi}$ каждый из контактов $[b_{2n-5}, a_{m-1}]$, $[a_{m-1}, a_m]$ и $[a_{m-1}, b_m]$ схемы S_M проводит, так как это контакты \bar{x}_n, x_i и \bar{x}_j соответственно (см. определения блоков V_{m-1} и V_m). Следовательно, в данной схеме есть проводимость между полюсом b_0 и каждым из полюсов a_m, b_m , что и требовалось доказать.

2.2. Пусть $\beta = 0$. Тогда $\tilde{\pi} = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1)$. На наборе $\tilde{\pi}$ каждый из контактов $[b_{2n-5}, b_{m-1}]$, $[b_{m-1}, a_m]$ и $[b_{m-1}, b_m]$ схемы S_M проводит, так как это контакты x_n, \bar{x}_j и x_i соответственно (см. определения блоков V_{m-1} и V_m). Следовательно, в данной схеме есть проводимость между полюсом b_0 и каждым из полюсов a_m, b_m . Свойство (vi), а вместе с ним лемма 5 доказаны. \square

Сложность построенной схемы S_M , как видно из рис. 7 и 8, не более чем на 8 превышает сложность схемы $S_{\tilde{\alpha}}$, т. е. не превосходит $8n - 12$.

Лемма 6. *Для любой булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 3$, существует такая $L_{(n)}$ -схема S , составленная из чётного числа t $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ также чётно, что на любом двоичном наборе $\tilde{\tau}$ длины n , не принадлежащем множеству $M_0 = \{(\tilde{0}^n), (\tilde{0}^{n-1}, 1), (\tilde{1}^{n-1}, 0), (\tilde{1}^n)\}$, проводимости между полюсами b_0 и a_0 , b_0 и a_m , b_0 и b_m схемы S равны 0, $f(\tilde{\tau})$, $f(\tilde{\tau})$ соответственно.*

Доказательство. Построим сначала вспомогательную $L_{(n)}$ -схему S_0 . По определению она однозначно задаётся числом $m_0 \in \mathbb{N}$ и $L_{(n)}$ -блоками V_1, \dots, V_{m_0} . Положим $m_0 = 2n - 4$, $V_{2j-1} = B_{j,j}^{j,j}$, $V_{2j} = B_{j+1,j}^{j+1,j}$ для каждого $j = 1, \dots, n - 2$. Вид схемы S_0 показан на рис. 9.

Докажем свойство (vii) этой схемы: функция проводимости между её вершинами b_0 и b_{2j} тождественно равна 1 для любого $j \in \{1, \dots, n - 2\}$. Достаточно доказать, что функция проводимости между вершинами b_{2j-2} и b_{2j} в схеме S_0 тождественно равна 1 для любого $j \in \{1, \dots, n - 2\}$. Между этими вершинами в данной схеме есть, в частности, цепи $b_{2j-2} - b_{2j-1} - b_{2j}$ и $b_{2j-2} - a_{2j-1} - b_{2j}$. В силу определения блоков V_{2j-1} и V_{2j} первая из этих цепей содержит два контакта x_j , а вторая — два контакта \bar{x}_j . Таким образом, функция проводимости между вершинами

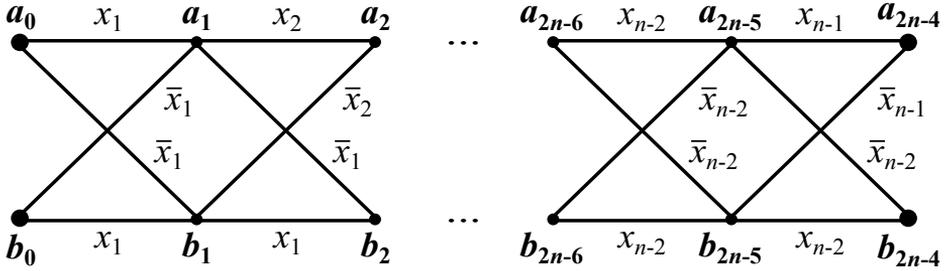


Рис. 9. Схема S_0

b_{2j-2} и b_{2j} в схеме S_0 не меньше $x_j \vee \bar{x}_j \equiv 1$, т. е. тождественно равна 1. Свойство (vii) доказано.

Докажем свойство (viii) схемы S_0 : на любом двоичном наборе $\tilde{\tau} = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, не принадлежащем множеству M_0 , в этой схеме есть проводимость между полюсами b_0 и a_{2n-4} . Из соотношения $\tilde{\tau} \notin M_0$ следует, что не все из чисел $\tau_1, \dots, \tau_{n-1}$ равны между собой. Пусть $j \in \{1, \dots, n-2\}$ — максимальной такой индекс, что $\tau_j \neq \tau_{j+1}$. В силу свойства (vii) достаточно доказать, что в схеме S_0 на наборе $\tilde{\tau}$ есть проводимость между вершинами b_{2j-2} и a_{2j} , а также между вершинами a_{2j} и a_{2n-4} . Между вершинами b_{2j-2} и a_{2j} в данной схеме есть, в частности, цепи $b_{2j-2} - a_{2j-1} - a_{2j}$ и $b_{2j-2} - b_{2j-1} - a_{2j}$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} первая из этих цепей содержит по одному контакту \bar{x}_j и x_{j+1} , а вторая цепь — по одному контакту x_j и \bar{x}_{j+1} . Одна из них проводит на наборе $\tilde{\tau}$, так как $\tau_j \neq \tau_{j+1}$. Между вершинами a_{2j} и a_{2n-4} в схеме S также есть проводимость на наборе $\tilde{\tau}$. Действительно, при $j = n-2$ это очевидно; в случае $j \leq n-3$ в силу выбора числа j выполнено соотношение $\tau_{j+1} = \tau_{j+2} = \dots = \tau_{n-1}$, поэтому либо цепь $a_{2j} - a_{2j+1} - \dots - a_{2n-5} - a_{2n-4}$, состоящая из контактов $x_{j+1}, x_{j+2}, \dots, x_{n-1}$, либо цепь $a_{2j} - b_{2j+1} - a_{2j+2} - \dots - b_{2n-5} - a_{2n-4}$, состоящая из контактов $\bar{x}_{j+1}, \bar{x}_{j+2}, \dots, \bar{x}_{n-1}$, проводит на наборе $\tilde{\tau}$ (некоторые из этих контактов могут входить в одну из рассматриваемых цепей по два раза). Свойство (viii) доказано.

Разобьём все двоичные наборы длины n , кроме наборов из множества M_0 , на $2^{n-1} - 2$ пар наборов, различающихся только в последней компоненте. Пусть d — число таких пар, в каждой из которых хотя бы один набор является нулевым набором функции $f(\tilde{x}^n)$. Если $d = 0$, то положим $\hat{S} = S_0$ и $m = 2n - 4$. В случае же $d \geq 1$ обозначим подмножества

указанных d пар наборов, состоящие из всех нулевых наборов функции f , содержащихся в этих парах, через M_1, \dots, M_d (в произвольном порядке). Тогда $|M_i| \in \{1, 2\}$ для любого $i \in \{1, \dots, d\}$ и множество $M_1 \cup \dots \cup M_d$ совпадает со множеством всех нулевых наборов функции $f(\tilde{x}^n)$, не лежащих в множестве M_0 (при $d = 0$ последнее утверждение также верно, если положить $M_1 \cup \dots \cup M_d = \emptyset$). Для каждого $M \in \{M_1, \dots, M_d\}$ по лемме 5 построим $L_{(n)}$ -схему S_M , обладающую свойствами (v), (vi). Определим $L_{(n)}$ -схему \hat{S} следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы \hat{S} совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы S_0 ; полюса a_{2n-4} и b_{2n-4} схемы S_0 совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы S_{M_1} и для удобства объявляются вершинами соответственно a^1 и b^1 схемы \hat{S} ; для любого $i \in \{1, \dots, d-1\}$ (при $d \geq 2$) полюса a_{m_i} и b_{m_i} схемы S_{M_i} , где m_i — некоторое натуральное число, совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы $S_{M_{i+1}}$ и для удобства объявляются вершинами соответственно a^{i+1} и b^{i+1} схемы \hat{S} ; полюса a_m и b_m схемы \hat{S} совпадают с полюсами соответственно a_{m_d} и b_{m_d} схемы S_{M_d} , где m, m_d — некоторые натуральные числа, и для удобства объявляются вершинами соответственно a^{d+1} и b^{d+1} схемы \hat{S} . Вид схемы \hat{S} показан на рис. 10.

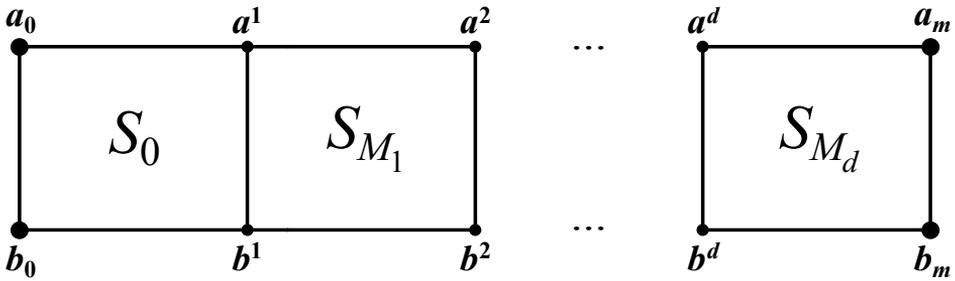


Рис. 10. Схема \hat{S}

Определим теперь $L_{(n)}$ -схему S . Рассмотрим четыре случая.

Случай А. Схема \hat{S} составлена из чётного числа $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ также чётно. Тогда положим $S = \hat{S}$.

Случай Б. Схема \hat{S} составлена из нечётного числа $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ чётно. Определим схему S следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы \hat{S} ; полюса a_m и b_m схемы S совпадают с полюсами соответ-

ственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{m+1} вида $B_{1,1}^{1,1}$; полюса a_{m+1} и b_{m+1} схемы S совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_{m+1} (см. рис. 11).

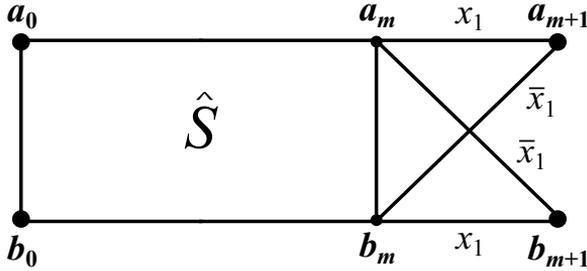


Рис. 11. Схема S в случае Б

Случай В. Схема \hat{S} составлена из нечётного числа $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ нечётно. Определим схему S следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы \hat{S} ; полюса a_m и b_m схемы \hat{S} совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{m+1} вида $B_{n,n}^{n,n}$; полюса a_{m+1} и b_{m+1} схемы S совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_{m+1} (см. рис. 11; все контакты переменной x_1 в правом блоке надо заменить на соответствующие контакты переменной x_n).

Случай Г. Схема \hat{S} составлена из чётного числа $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ нечётно. Определим схему S следующим образом: полюса a_0 и b_0 схемы S совпадают с полюсами соответственно a_0 и b_0 схемы \hat{S} ; полюса a_m и b_m схемы \hat{S} совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{m+1} вида $B_{1,1}^{1,1}$; полюса A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_{m+1} совпадают с полюсами соответственно A_1 и A_2 $L_{(n)}$ -блока \mathbf{B}_{m+2} вида $B_{n,n}^{n,n}$ и объявляются вершинами соответственно a_{m+1} и b_{m+1} схемы S ; полюса a_{m+2} и b_{m+2} схемы S совпадают с полюсами соответственно A_3 и A_4 блока \mathbf{B}_{m+2} (см. рис. 12).

Легко видеть, что в каждом из случаев А–Г схема S является $L_{(n)}$ -схемой и составлена из чётного числа $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ также чётно.

Далее будем параллельно рассматривать случаи А–Г. Пусть $\tilde{\tau}$ — произвольный двоичный набор длины n , не принадлежащий множеству M_0 . Докажем сначала, что проводимость между полюсами b_0 и a_0 схемы S на этом наборе равна 0, т. е. отсутствует. Обозначим произвольную несамопересекающуюся цепь в схеме S между этими полюсами через C , а вер-

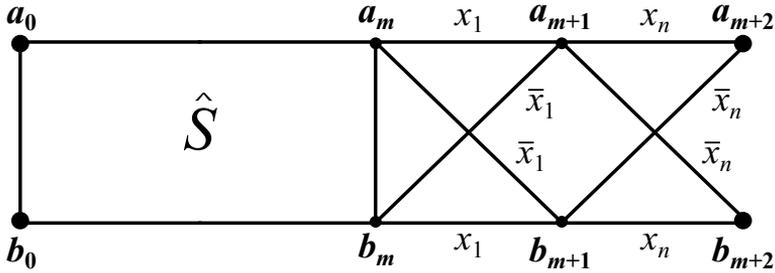


Рис. 12. Схема S в случае Γ

шины этой цепи при движении от a_0 к b_0 — через v_0, \dots, v_s , где $v_0 = a_0$, $v_s = b_0$. Достаточно доказать, что данная цепь не проводит на наборе $\tilde{\tau}$. Рассмотрим два случая.

1. Цепь C целиком содержится в подсхеме S_0 . Пусть $t \in \{0, \dots, 2n - 4\}$ — максимальное такое число, что среди вершин v_0, \dots, v_s есть хотя бы одна вершина $v_{s'}$, принадлежащая множеству $\{a_t, b_t\}$, где a_t, b_t — вершины $L_{(n)}$ -схемы S_0 . Очевидно, что $t \geq 1$, поэтому $0 < s' < s$. Вершина $v_{s'}$ соединена в схеме S_0 контактами с вершинами $a_{t-1}, b_{t-1}, a_{t+1}$ и b_{t+1} , если $t \leq 2n - 5$, и с вершинами a_{t-1} и b_{t-1} , если $t = 2n - 4$. Отсюда и из выбора числа t следует соотношение $v_{s'-1}, v_{s'+1} \in \{a_{t-1}, b_{t-1}\}$; кроме того, $v_{s'-1} \neq v_{s'+1}$. Поэтому в цепи C обязательно одновременно содержатся либо контакты $[a_{t-1}, a_t]$ и $[b_{t-1}, a_t]$, либо контакты $[a_{t-1}, b_t]$ и $[b_{t-1}, b_t]$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} схемы S_0 , где $j = 1, \dots, n - 2$, это либо контакты x_j и \bar{x}_j , либо контакты x_{j+1} и \bar{x}_{j+1} для некоторого $j \in \{1, \dots, n - 2\}$, т. е. противоположные контакты. Следовательно, данная цепь не может проводить на наборе $\tilde{\tau}$.

2. Цепь C не содержится целиком в подсхеме S_0 . Из вида этой подсхемы легко следует, что цепь C можно разбить на участок C_a , соединяющий вершину a_0 с какой-то вершиной w , не содержащейся в S_0 , и участок C_b , соединяющий вершины w и b_0 ; для любого $t' \in \{0, \dots, 2n - 4\}$ на участке C_a (C_b) обязательно содержится вершина $w_{t'}^a$ (соответственно, $w_{t'}^b$), принадлежащая множеству $\{a_{t'}, b_{t'}\}$; при этом $w_{t'}^a \neq w_{t'}^b$, так как цепь C несамопересекающаяся. Отсюда вытекает, что $s > 2(2n - 3)$, $v_{t'} = w_{t'}^a$ и $v_{s-t'} = w_{t'}^b$ для любого $t' \in \{0, \dots, 2n - 4\}$ (последние два равенства можно доказать индукцией по t'); таким образом, $v_{t'}, v_{s-t'} \in \{a_{t'}, b_{t'}\}$ и $v_{t'} \neq v_{s-t'}$. Рассмотрим пять подслучаев.

2.1. Пусть $v_{t'} = a_{t'}$ для любого $t' \in \{0, \dots, 2n - 4\}$. Тогда в цепи C содержатся контакты $[a_0, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_{2n-5}, a_{2n-4}]$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} схемы S_0 , где $j = 1, \dots, n - 2$, это контакты x_1, x_2, \dots, x_{n-1} (некоторые из этих контактов при $n \geq 4$ повторяются). Хотя бы одна из первых $n - 1$ компонент набора $\tilde{\tau}$ равна 0, так как $\tilde{\tau} \notin M_0$. Поэтому цепь C не может проводить на данном наборе.

2.2. Пусть $v_{t'} = a_{t'}$ для любого чётного $t' \in \{0, \dots, 2n - 4\}$ и $v_{t'} = b_{t'}$ для любого нечётного $t' \in \{0, \dots, 2n - 4\}$. Тогда в цепи C содержатся контакты $[a_0, b_1], [b_1, a_2], \dots, [b_{2n-5}, a_{2n-4}]$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} схемы S_0 , где $j = 1, \dots, n - 2$, это контакты $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_{n-1}$ (некоторые из этих контактов при $n \geq 4$ повторяются). Хотя бы одна из первых $n - 1$ компонент набора $\tilde{\tau}$ равна 1, так как $\tilde{\tau} \notin M_0$. Поэтому цепь C не может проводить на данном наборе.

2.3. Пусть существует такое $t' \in \{0, \dots, 2n - 6\}$, что $v_{t'} = a_{t'}$, $v_{t'+1} = a_{t'+1}$ и $v_{t'+2} = b_{t'+2}$. Тогда в цепи C содержатся контакты $[a_{t'}, a_{t'+1}]$ и $[a_{t'+1}, b_{t'+2}]$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} схемы S_0 , где $j = 1, \dots, n - 2$, это либо контакты x_j и \bar{x}_j соответственно, либо контакты x_{j+1} и \bar{x}_{j+1} соответственно для некоторого $j \in \{1, \dots, n - 2\}$, т. е. противоположные контакты. Поэтому данная цепь не может проводить на наборе $\tilde{\tau}$.

2.4. Пусть существует такое $t' \in \{0, \dots, 2n - 6\}$, что $v_{t'} = a_{t'}$, $v_{t'+1} = b_{t'+1}$ и $v_{t'+2} = b_{t'+2}$. Тогда $v_{s-t'} = b_{t'}$, $v_{s-t'-1} = a_{t'+1}$ и $v_{s-t'-2} = a_{t'+2}$, поэтому в цепи C содержатся контакты $[a_{t'}, b_{t'+1}]$, $[b_{t'+1}, b_{t'+2}]$, $[b_{t'}, a_{t'+1}]$ и $[a_{t'+1}, a_{t'+2}]$. В силу определения блоков B_{2j-1} и B_{2j} схемы S_0 , где $j = 1, \dots, n - 2$, это либо контакты \bar{x}_j , x_j , \bar{x}_j и x_{j+1} соответственно, либо контакты \bar{x}_j , x_{j+1} , \bar{x}_{j+1} и x_{j+1} соответственно для некоторого $j \in \{1, \dots, n - 2\}$. Среди них есть противоположные контакты, поэтому данная цепь не может проводить на наборе $\tilde{\tau}$.

2.5. Пусть существует такое $t' \in \{0, \dots, 2n - 6\}$, что $v_{t'} = b_{t'}$, $v_{t'+1} = a_{t'+1}$ и $v_{t'+2} = a_{t'+2}$. Тогда $v_{s-t'} = a_{t'}$, $v_{s-t'-1} = b_{t'+1}$ и $v_{s-t'-2} = b_{t'+2}$, значит, в цепи C содержатся контакты $[b_{t'}, a_{t'+1}]$, $[a_{t'+1}, a_{t'+2}]$, $[a_{t'}, b_{t'+1}]$ и $[b_{t'+1}, b_{t'+2}]$. Этот подслучай сводится к предыдущему.

Нетрудно заметить, что подслучаи 2.1–2.5 охватывают все возможные подслучаи случая 2. Тем самым доказано, что проводимость между полюсами b_0 и a_0 схемы S на наборе $\tilde{\tau}$ равна 0.

Обозначим через m' число $L_{(n)}$ -блоков в схеме S (в силу построения этой схемы $m' \in \{m, m + 1, m + 2\}$). Докажем, что проводимости между полюсами b_0 и $a_{m'}$, а также между полюсами b_0 и $b_{m'}$ схемы S на наборе $\tilde{\tau}$ равны $f(\tilde{\tau})$. Рассмотрим два случая.

1'. Пусть $f(\tilde{\tau}) = 0$. Тогда $d \geq 1$ и $\tilde{\tau} \in M_i$ для некоторого $i \in \{1, \dots, d\}$. Предположим, что на наборе $\tilde{\tau}$ в схеме S есть несамопересекающаяся проводящая цепь между полюсами b_0 и v для некоторого $v \in \{a_{m'}, b_{m'}\}$. Очевидно, что в указанной цепи можно выбрать участок, соединяющий одну из вершин a^i, b^i с одной из вершин a^{i+1}, b^{i+1} и лежащий целиком внутри подсхемы S_{M_i} , однако это противоречит выполнению свойства (v) для схемы S_{M_i} с учётом того, что вершины a^i, b^i, a^{i+1} и b^{i+1} совпадают с полюсами a_0, b_0, a_{m_i} и b_{m_i} данной схемы соответственно. Поэтому проводимости между полюсами b_0 и $a_{m'}$, а также между полюсами b_0 и $b_{m'}$ схемы S на наборе $\tilde{\tau}$ равны $0 = f(\tilde{\tau})$, что и требовалось доказать.

2'. Пусть $f(\tilde{\tau}) = 1$. Докажем свойство (ix) схемы \hat{S} : в этой схеме на наборе $\tilde{\tau}$ есть проводимость между полюсами b_0 и a_m , а также между полюсами b_0 и b_m . В силу свойств (vii), (viii) в подсхеме S_0 есть проводимость между полюсами b_0 и b_{2n-4} , а также между полюсами b_0 и a_{2n-4} . Если $d = 0$, то $\hat{S} = S_0$ и $m = 2n - 4$, откуда следует требуемое утверждение. В случае $d \geq 1$ имеем $\tilde{\tau} \notin M_1 \cup \dots \cup M_d$. В силу свойства (vi) в подсхеме S_{M_d} есть проводимость между её полюсами v^d и a_m , а также между её полюсами v^d и b_m для некоторого $v^d \in \{a^d, b^d\}$. В случае $d \geq 2$ в силу свойства (vi) в подсхеме $S_{M_{d-1}}$ есть проводимость между её полюсами v^{d-1} и v^d для некоторого $v^{d-1} \in \{a^{d-1}, b^{d-1}\}$. В случае $d \geq 3$ в силу свойства (vi) в подсхеме $S_{M_{d-2}}$ есть проводимость между её полюсами v^{d-2} и v^{d-1} для некоторого $v^{d-2} \in \{a^{d-2}, b^{d-2}\}$, и т. д. В итоге получаем, что в схеме \hat{S} есть проводимость между вершинами v^1 и a_m , а также между вершинами v^1 и b_m для некоторого $v^1 \in \{a^1, b^1\} = \{a_{2n-4}, b_{2n-4}\}$. Выше было показано, что в подсхеме S_0 есть проводимость между полюсами b_0 и v^1 . Таким образом, в схеме \hat{S} есть проводимость между полюсами b_0 и a_m , а также между полюсами b_0 и b_m . Свойство (ix) доказано.

В случае А в силу равенства $S = \hat{S}$ получаем, что проводимости между полюсами b_0 и $a_{m'}$, а также между полюсами b_0 и $b_{m'}$ схемы S на наборе $\tilde{\tau}$ равны $1 = f(\tilde{\tau})$, что и требовалось доказать.

В случае Б в силу определения блока B_{m+1} вершина a_{m+1} соединена в схеме S с вершинами a_m и b_m контактами x_1 и \bar{x}_1 соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$; вершина b_{m+1} соединена с вершинами a_m и b_m контактами \bar{x}_1 и x_1 соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$. С учётом свойства (ix) в схеме S на указанном наборе проводимость между вершиной b_0 и каждым из полюсов a_{m+1}, b_{m+1} равна $1 = f(\tilde{\tau})$, что и требовалось доказать.

В случае В требуемое утверждение доказывается аналогично случаю Б с заменой контактов x_1 и \bar{x}_1 на контакты x_n и \bar{x}_n соответственно.

В случае Γ по аналогии со случаем B устанавливается, что в схеме S на наборе $\tilde{\tau}$ есть проводимость между вершиной b_0 и каждой из вершин a_{m+1}, b_{m+1} . В силу определения блока B_{m+2} вершина a_{m+2} соединена в этой схеме с вершинами a_{m+1} и b_{m+1} контактами x_n и \bar{x}_n соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$; вершина b_{m+2} соединена с вершинами a_{m+1} и b_{m+1} контактами \bar{x}_n и x_n соответственно, один из которых проводит на наборе $\tilde{\tau}$. Поэтому в схеме S на указанном наборе проводимость между вершиной b_0 и каждым из полюсов a_{m+2}, b_{m+2} равна $1 = f(\tilde{\tau})$, что и требовалось доказать.

Во всех случаях доказано, что проводимости между полюсами b_0 и a_m , а также между полюсами b_0 и b_m схемы S на наборе $\tilde{\tau}$ равны $f(\tilde{\tau})$. Лемма 6 доказана. \square

Оценим сверху сложности схем, построенных в ходе доказательства леммы 6. Сложность схемы S_0 равна $4(2n - 4) = 8n - 16$. Сложность каждой из схем S_{M_1}, \dots, S_{M_d} (при $d \geq 1$) не превосходит $8n - 12$. Из определения числа d следует, что $d \leq 2^{n-1} - 2$. Поэтому сложность схемы \hat{S} не превосходит

$$8n - 16 + d(8n - 12) \leq 8n - 16 + (2^{n-1} - 2)(8n - 12) = (4n - 6) \cdot 2^n - 8n + 8$$

(см. рис. 10). Наконец, сложность схемы S не более чем на 8 превышает сложность схемы \hat{S} (см. разбор случаев A – Γ и рис. 11, 12), т. е. не превосходит $(4n - 6) \cdot 2^n - 8n + 16$.

Лемма 7. Любую булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 3$, удовлетворяющую условиям $f(\tilde{0}^n) = f(\tilde{1}^n) = 1$, $f(\tilde{0}^{n-1}, 1) = f(\tilde{1}^{n-1}, 0) = 0$, можно реализовать $L'_{(n)}$ -схемой.

Доказательство. В силу леммы 6 существует такая $L_{(n)}$ -схема S , составленная из чётного числа m $L_{(n)}$ -блоков, среди которых число блоков вида $B_{n,n}^{n,n}$ также чётно, что на любом двоичном наборе $\tilde{\tau}$ длины n , не принадлежащем множеству $M_0 = \{(\tilde{0}^n), (\tilde{0}^{n-1}, 1), (\tilde{1}^{n-1}, 0), (\tilde{1}^n)\}$, проводимости между полюсами b_0 и a_0 , b_0 и a_m , b_0 и b_m схемы S равны 0, $f(\tilde{\tau})$, $f(\tilde{\tau})$ соответственно. Пусть S' — контактная схема с полюсами b_0 и a_m , получающаяся из схемы S добавлением вершины c_1 и соединением её с полюсами b_m и a_0 схемы S контактами x_1 и x_n соответственно, а также добавлением вершины c_2 и соединением её с полюсами b_m и a_0 схемы S контактами \bar{x}_1 и \bar{x}_n соответственно (см. рис. 3). Тогда по определению S' является $L'_{(n)}$ -схемой.

Докажем, что схема S' реализует функцию $f(\tilde{x}^n)$. Для этого достаточно доказать, что функция проводимости $h(\tilde{x}^n)$ данной схемы на произвольном двоичном наборе $\tilde{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ принимает значение $f(\tilde{\sigma})$. Рассмотрим четыре случая.

1. Пусть $f(\tilde{\sigma}) = 1$ и $\tilde{\sigma} \notin M_0$. Тогда проводимость между полюсами b_0 и a_m схемы S на наборе $\tilde{\sigma}$ равна $f(\tilde{\sigma}) = 1$. Следовательно, в подсхеме S , а значит, и в схеме S' есть проводящая на этом наборе цепь между полюсами b_0 и a_m , откуда

$$h(\tilde{\sigma}) = 1 = f(\tilde{\sigma}).$$

2. Пусть $f(\tilde{\sigma}) = 0$ и $\tilde{\sigma} \notin M_0$. Тогда проводимости между полюсами b_0 и a_0 , b_0 и a_m , b_0 и b_m схемы S на наборе $\tilde{\sigma}$ равны 0, $f(\tilde{\sigma}) = 0$, $f(\tilde{\sigma}) = 0$ соответственно, т. е. в подсхеме S нет проводящей на этом наборе цепи ни между какой из пар вершин b_0 и a_0 , b_0 и a_m , b_0 и b_m . Добавление к схеме S контактов $[a_0, c_1]$, $[c_1, b_m]$, $[a_0, c_2]$ и $[c_2, b_m]$ для получения из неё схемы S' никак не повлияет на это свойство. Следовательно, в схеме S' нет ни одной проводящей на наборе $\tilde{\sigma}$ цепи между её полюсами b_0 и a_m , откуда

$$h(\tilde{\sigma}) = 0 = f(\tilde{\sigma}).$$

3. Пусть $f(\tilde{\sigma}) = 1$ и $\tilde{\sigma} \in M_0$. Тогда $\tilde{\sigma} \in \{(\tilde{0}^n), (\tilde{1}^n)\}$ и в силу леммы 3 схема S' проводит на наборе $\tilde{\sigma}$, откуда

$$h(\tilde{\sigma}) = 1 = f(\tilde{\sigma}).$$

4. Пусть $f(\tilde{\sigma}) = 0$ и $\tilde{\sigma} \in M_0$. Тогда $\tilde{\sigma} \in \{(\tilde{0}^{n-1}, 1), (\tilde{1}^{n-1}, 0)\}$ и в силу леммы 3 схема S' не проводит на наборе $\tilde{\sigma}$, откуда

$$h(\tilde{\sigma}) = 0 = f(\tilde{\sigma}).$$

Лемма 7 доказана. □

Сложность построенной схемы S' на 4 превышает сложность схемы S , а значит, не превосходит $(4n - 6) \cdot 2^n - 8n + 20 < 4n \cdot 2^n$ (напомним, что $n \geq 3$).

6. Основные теоремы

В теореме 1 описаны все булевы функции f , для которых $D(f) = 0$, $D(f) = 1$ (таких нет), $D(f) = 2$ и $D(f) = 3$. Теорема 2 даёт описание достаточно обширного класса булевых функций f , для которых $D(f) = 4$.

Теорема 2. Пусть для булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, $n \geq 3$, существует такой индекс $i \in \{1, \dots, n\}$ и такие булевы константы $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, что

$$f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = 1, \quad (6)$$

$$f(\sigma_1, \dots, \bar{\sigma}_{i-1}, \bar{\sigma}_i, \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_n) = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{i-1}, \sigma_i, \bar{\sigma}_{i+1}, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0. \quad (7)$$

Тогда $D(f) = 4$.

Доказательство. Докажем неравенство $D(f) \leq 4$. Рассмотрим функцию $f'(\tilde{x}^n) = f(x_1^{\sigma_1}, \dots, x_n^{\sigma_n})$. Тогда $f(\tilde{x}^n) = f'(x_1^{\sigma_1}, \dots, x_n^{\sigma_n})$ и функция $f(\tilde{x}^n)$ родственна функции $f'(\tilde{x}^n)$. В силу леммы 1 достаточно доказать неравенство $D(f') \leq 4$. Рассмотрим теперь функцию $f''(\tilde{x}^n) = f'(x_1, \dots, x_{i-1}, x_n, x_{i+1}, \dots, x_{n-1}, x_i)$, получающуюся из функции f' перестановкой переменных x_i и x_n (в случае $i = n$ полагаем $f'' = f'$). Тогда $f'(\tilde{x}^n) = f''(x_1, \dots, x_{i-1}, x_n, x_{i+1}, \dots, x_{n-1}, x_i)$ и функция $f'(\tilde{x}^n)$ родственна функции $f''(\tilde{x}^n)$. В силу леммы 1 достаточно доказать неравенство $D(f'') \leq 4$. Заметим, что

$$f''(\tilde{0}^n) = f'(\tilde{0}^n) = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = 1,$$

$$f''(\tilde{1}^n) = f'(\tilde{1}^n) = f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1,$$

$$f''(\tilde{0}^{n-1}, 1) = f'(0^{i-1}, 1, 0^{n-i}) = f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{i-1}, \sigma_i, \bar{\sigma}_{i+1}, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0,$$

$$f''(\tilde{1}^{n-1}, 0) = f'(1^{i-1}, 0, 1^{n-i}) = f(\sigma_1, \dots, \sigma_{i-1}, \bar{\sigma}_i, \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_n) = 0,$$

а в таком случае требуемое неравенство следует из леммы 7, применяемой для функции $f''(\tilde{x}^n)$, и леммы 3.

Докажем теперь, что $D(f) \geq 4$. Из (6), (7) следуют соотношения

$$f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \neq f(\sigma_1, \dots, \sigma_{i-1}, \bar{\sigma}_i, \sigma_{i+1}, \dots, \sigma_n),$$

$$f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \neq f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{i-1}, \sigma_i, \bar{\sigma}_{i+1}, \dots, \bar{\sigma}_n),$$

откуда вытекает, что функция f существенно зависит от переменной x_i и хотя бы от одной из переменных из множества $\{x_1, \dots, x_n\} \setminus \{x_i\}$. Предположим, что $D(f) \leq 3$. Тогда в силу теоремы 1 и предыдущего предложения функция f существенно зависит ровно от двух переменных: x_i и x_j для некоторого $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ и родственна одной из функций $x_1 x_2$, $x_1 \vee x_2$. Поэтому существует такая булева функция $\varphi(x, y)$, что $f(\tilde{x}^n) = \varphi(x_i, x_j)$. Тогда из (6), (7) получаем

$$\varphi(\sigma_i, \sigma_j) = \varphi(\bar{\sigma}_i, \bar{\sigma}_j) = 1,$$

$$\varphi(\sigma_i, \bar{\sigma}_j) = \varphi(\bar{\sigma}_i, \sigma_j) = 0.$$

Для любых $\sigma_i, \sigma_j \in \{0, 1\}$ из последних двух соотношений следует, что $\varphi(x, y) \in \{x \oplus y, x \sim y\}$, поэтому $f(\tilde{x}^n) \in \{x_i \oplus x_j, x_i \sim x_j\}$. Но ни одна из функций $x_i \oplus x_j, x_i \sim x_j$ не родственна ни одной из функций $x_1 x_2, x_1 \vee x_2$; противоречие. Таким образом, $D(f) \geq 4$, а с учётом ранее установленного неравенства $D(f) \leq 4$ получаем равенство $D(f) = 4$. Теорема 2 доказана. \square

Из доказательства неравенства $D(f'') \leq 4$ в теореме 2, верхней оценки сложности схемы S' , приведённой в конце предыдущего раздела, и перехода от схемы S_1 к схеме S_2 в доказательстве леммы 1 легко вытекает, что любую булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, удовлетворяющую условиям теоремы 2, можно реализовать неизбыточной контактной схемой сложности менее $4n \cdot 2^n$, допускающей ЕПТ длины 4.

Теорема 3. *Для почти всех булевых функций f от n переменных справедливо равенство $D(f) = 4$.*

Доказательство. Пусть $n \geq 3$. Нетрудно видеть, что множество всех двоичных наборов длины n можно разбить на 2^{n-2} попарно непересекающихся упорядоченных четвёрок наборов

$$U_{\sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}} = ((1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 1), (1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 0), \\ (0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 1), (0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 0)),$$

где $\sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}$ — булевы константы, образующие все возможные комбинации. Пусть F_n — множество булевых функций от n переменных, не принимающих ни на одной из этих четвёрок наборов ни одну из четвёрок значений $(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)$. Любая булева функция $f(\tilde{x}^n)$, не принадлежащая множеству F_n , удовлетворяет либо соотношениям

$$f(1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 1) = f(0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 0) = 1, \\ f(1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 0) = f(0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 1) = 0,$$

либо соотношениям

$$f(1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 0) = f(0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 1) = 1, \\ f(1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}, 1) = f(0, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_{n-1}, 0) = 0$$

для некоторых $\sigma_2, \dots, \sigma_{n-1} \in \{0, 1\}$. Тогда функция $f(\tilde{x}^n)$ удовлетворяет условию теоремы 2 при $i = n$ и $\sigma_1 = 1$ для некоторого $\sigma_n \in \{0, 1\}$, поэтому $D(f) = 4$.

Найдём мощность множества F_n . На каждой из 2^{n-2} четвёрок наборов $U_{\sigma_1, \dots, \sigma_{n-2}}$ любая функция из этого множества может принимать любую из $2^4 - 2 = 14$ четвёрок значений. Следовательно, $|F_n| = 14^{2^{n-2}}$. Тогда

$$\frac{|F_n|}{2^{2^n}} = \frac{14^{2^{n-2}}}{16^{2^{n-2}}} = \left(\frac{7}{8}\right)^{2^{n-2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Таким образом, отношение числа булевых функций из множества F_n к общему числу булевых функций от n переменных (2^{2^n}) стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$. Выше было показано, что для любой булевой функции $f(\tilde{x}^n)$, не принадлежащей множеству F_n , выполнено равенство $D(f) = 4$, откуда следует справедливость теоремы 3. \square

7. Заключение

Описанный в работе для почти всех булевых функций от n переменных метод синтеза реализующих их контактных схем, допускающих единичные проверяющие тесты длины 4 относительно обрывов и замыканий контактов, ввиду малой длины тестов, а значит, малого времени, необходимого для тестирования таких схем, может найти практическое применение. Сложности указанных схем при этом не превосходят $4n \cdot 2^n$, что по порядку в n^2 раз больше нижней оценки сложности реализации почти любой булевой функции от n переменных в классе контактных схем (см., например, [1, с. 60, лемма 8]).

Вместе с тем, пока не удалось получить единой верхней оценки длины минимального единичного проверяющего теста для **любой** булевой функции от n переменных, т. е. верхней оценки величины $D_{\text{ЕП}}(n)$, улучшающей оценку $D_{\text{ЕП}}(n) = O\left(\frac{2^n}{n\sqrt{n}}\right)$ из [7]. Представляет интерес также изучение возможностей реализации всех или почти булевых функций от n переменных контактными схемами, допускающими короткие единичные диагностические тесты, либо контактными схемами, допускающими короткие проверяющие или диагностические тесты относительно обрывов и замыканий не более k контактов, где $k \geq 2$ — заданное натуральное число.

Список литературы

- [1] Лупанов О.Б. Асимптотические оценки сложности управляющих систем. — М.: Изд-во МГУ, 1984.

- [2] Чегис И. А., Яблонский С. В. Логические способы контроля работы электрических схем // Труды МИАН. — 1958. — **51**. — С. 270–360.
- [3] Яблонский С. В. Надёжность и контроль управляющих систем // Мат-лы Всесоюз. семинара по дискретн. матем. и её прилож. (Москва, 31 января–2 февраля 1984 г.) / Под ред. О. Б. Лупанова. — М.: Изд-во МГУ, 1986. — С. 7–12.
- [4] Яблонский С. В. Некоторые вопросы надёжности и контроля управляющих систем // Матем. вопросы киберн. Вып. 1. — М.: Наука, 1988. — С. 5–25.
- [5] Редькин Н. П. Надёжность и диагностика схем. — М.: Изд-во МГУ, 1992.
- [6] Мадатян Х. А. Полный тест для неповторных контактных схем // Проблемы киберн. Вып. 23. — М.: Наука, 1970. — С. 103–118.
- [7] Мадатян Х. А. Построение единичных тестов для контактных схем // Сборник работ по матем. киберн. — М.: ВЦ АН СССР, 1981. — С. 77–86.
- [8] Редькин Н. П. О полных проверяющих тестах для контактных схем // Методы дискретн. анализа в исслед. экстрем. структур. Вып. 39. — Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1983. — С. 80–87.
- [9] Романов Д. С. О синтезе контактных схем, допускающих короткие проверяющие тесты // Уч. зап. Казан. ун-та. Физ.-матем. науки. — 2014. — **156**, кн. 3. — С. 110–115.
- [10] Романов Д. С., Романова Е. Ю. О единичных проверяющих тестах для схем переключательного типа // Изв. высш. учебн. завед. Поволж. регион. Физ.-матем. науки. — 2015. — № 1 (33). — С. 5–23.
- [11] Попков К. А. О тестах замыкания для контактных схем // Дискретн. матем. — 2016. — **28**, вып. 1. — С. 87–100.
- [12] Попков К. А. О проверяющих тестах размыкания для контактных схем // Дискретн. матем. — 2017. — **29**, вып. 4. — С. 66–86.
- [13] Попков К. А. О диагностических тестах размыкания для контактных схем // Дискретн. матем. — 2019. — **31**, вып. 2. — С. 124–143.
- [14] Яблонский С. В. Введение в дискретную математику. — М.: Наука, 1986.

**Short single fault detection tests for contact circuits under breaks
and closures of contacts**
Попков К.А.

We consider a problem of implementation of Boolean functions by irredundant two-pole contact circuits which allow short single fault detection tests regarding breaks and closures of contacts. We describe all functions which the minimal length of such a test equals 0, 1, 2, and 3 for. We prove that, for almost all Boolean functions on n variables, this length equals 4.

Keywords: contact circuit, Boolean function, contact break, contact closure, fault detection test.